

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE



**Fakulta elektrotechnická
Katedra mikroelektroniky**

Ramanova spektroskopie organických polovodičů

Bakalářské práce

Iakov Elistratov

Vedoucí práce: Ing. Alexandr Lapos, Ph.D.

Praha, 2021

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Elistratov** Jméno: **Iakov** Osobní číslo: **461220**
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra mikroelektroniky**
Studijní program: **Elektronika a komunikace**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Ramanova spektroskopie organických polovodičů

Název bakalářské práce anglicky:

Raman Spectroscopy of Organic Semiconductors

Pokyny pro vypracování:

- Prostudujte teoretické základy Ramanova rozptylu a Ramanovy mikroskopie.
- Seznamte se s obsluhou Ramanova konfokálního mikroskopu Renishaw inVia Qontor.
- Připravte tenké filmy organických polovodičů (např. polyanilin) za různých polymerizačních podmínek a změřte jejich spektra s použitím různých vlnových délek excitačního laseru.
- Pro připravené tenké vrstvy provedte také AFM charakterizaci a elektrickou charakterizaci.
- Naměřené výsledky zpracujte a vyhodnotěte.

Seznam doporučené literatury:

- [1] J. Stejskal et al., "Conducting Polymers: Polyaniline," in Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2015, pp. 1–44.
[2] M. A. C. Mazzeu, L. K. Faria, A. de M. Cardoso, A. M. Gama, M. R. Baldan, and E. S. Gonçalves, "Structural and morphological characteristics of polyaniline synthesized in pilot scale," J. Aerosp. Technol. Manag., vol. 9, no. 1, pp. 39–47, Feb. 2017, doi: 10.5028/jatm.v9i1.726.
[3] I. Šeděnková, J. Prokeš, M. Trchová, and J. Stejskal, "Conformational transition in polyaniline films - Spectroscopic and conductivity studies of ageing," Polym. Degrad. Stab., vol. 93, no. 2, pp. 428–435, Feb. 2008, doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2007.11.015.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Alexandr Laposa, Ph.D., katedra mikroelektroniky FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **01.02.2021**

Termín odevzdání bakalářské práce: _____

Platnost zadání bakalářské práce: **30.09.2022**

Ing. Alexandr Laposa, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) práce

prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání

Podpis studenta

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

V Praze dne 13.8.2021

.....

Iakov Elistratov

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu práce Ing. Alexandru Laposovi, Ph.D., za jeho čas, odborné vedení, velkou podporu, trpělivost a pomoc při realizaci praktické části mé práce. Také bych chtěl poděkovat své rodině a nejbližším přátelům, kteří mi vždy byli velkou oporou po celou dobu mého studia.

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá využitím Ramanova mikrospektrometru ke studiu molekulární struktury organického polovodiče polyanilinu.

Teoretická část práce popisuje na základě dostupné literatury shrnutí základů Ramanova rozptylu v klasickém přiblížení, poznatky o fyzikálních principech v Ramanově spektroskopie, metodách analýzy a k tomu potřebnou instrumentaci a vlastností tenkých vrstev organického polovodiče polyanilinu. Konkrétně je pak probírána moderní Renishaw inVia Qontor Ramanův mikrospektrometr a vysvětlen jeho princip činnosti.

Praktická část je zaměřena na přípravě tenkých vrstev polyanilinu ve formě emeraldinové soli, které byly podrobně analyzovány provedením reálných laboratorních měření na Ramanově mikrospektrometru a tří různých excitačních laserů vlnových délek 830 nm, 633 nm, a 532 nm. Byla také provedena charakterizace pomocí AFM a SEM a změřeny základní elektrické vlastnosti vrstev.

Klíčová slova

Ramanova spektroskopie, Ramanův posuv, organické polovodiče, polyanilin

Abstract

This bachelor thesis deals with the use of Raman microspectrometer to study the molecular structure of the organic semiconductor polyaniline.

The theoretical part of the thesis describes, based on the available literature, a summary of the basics of Raman scattering in the classical approximation, knowledge of the physical principles in Raman spectroscopy, methods of analysis and the instrumentation required for this, and the properties of thin films of the organic semiconductor polyaniline. Specifically, the state-of-the-art Renishaw inVia Qontor Raman microspectrometer is then discussed and its operating principles explained.

The practical part focuses on the preparation of thin films of polyaniline in the form of emeraldine salt, which were analyzed in detail by performing real laboratory measurements on a Raman microspectrometer and three different excitation lasers of wavelengths 830 nm, 633 nm, and 532 nm. AFM and SEM characterization were also performed and the basic electrical properties of the layers were measured.

Keywords

Raman spectroscopy, Raman shift, organic semiconductors, polyaniline

Obsah

Úvod	1
1 Ramanova spektroskopie	2
1.1 Princip metody.....	2
1.1.1 Ramanův rozptyl.....	2
1.2 Ramanovo spektrum	4
1.2.1 Ramanovo spektrum uhlíkových materiálů	5
1.2.2 Vibrace molekul	7
1.2.3 Fluorescence	8
1.3 Aplikace Ramanovy spektroskopie	9
2 Instrumentace v Ramanově spektroskopii	10
2.1 Zdroj excitační energie	10
2.2 Disperzní prvek.....	12
2.3 Detektor	13
3 Ramanův mikroskop	15
3.1 Konfokální mikroskop	15
3.2 Konfokální Ramanův mikroskop.....	16
3.3 Renishaw inVia Qontor Ramanův mikrospektrometr	18
3.3.1 Hardwarové ovládání.....	18
3.3.2 Softwarové ovládání	21
4 Vodivé polymery	23
4.1 Polyanilin.....	23
5 Ramanova spektra polyanilinových filmů.....	24
5.1 Příprava vzorků.....	24
5.1.1 Syntéza tenkých filmů polyanilinu	24
5.2 Zpracování naměřených Ramanových spekter.....	25
5.2.1 Polyanilinové filmy na křemíkových podložkách	25
5.2.2 Vliv laserového záření na vzorek	38

6 AFM a SEM charakterizace vrstev (morfologie vzorků).....	39
6.1 Mikroskopie atomárních sil	39
6.2 Rastrovací elektronová mikroskopie	41
7 Elektrická charakterizace vrstev	43
Závěr	46
Literatura	47
Příloha A. Syntéza tenkých filmů polyanilinu	50
Příloha B. Vnitřní vybavení Ramanova mikrospektrometru a použitého software pro práci s tímto přístrojem	52
Příloha C. Měření na AFM mikroskopu	54
Příloha D. Měření elektrických vlastností.....	56

Seznam použitých symbolů a zkratek

E_1, E_2 (eV)	energie fotonu
ν_0 (Hz)	frekvence dopadajícího záření
ν_R (Hz)	frekvence rozptylového záření
h (eV Hz ⁻¹)	Planckova konstanta
$\tilde{\nu}$ (cm ⁻¹)	vlnočet
λ (nm)	vlnová délka záření
v (Hz)	frekvence excitačního záření
NA	numerická apertura
D_{xy}	laterální rozlišení
n	index lomu prostředí
θ	poloviční úhlová apertura
φ (°)	úhel dopadu světelného paprsku
CCD	charge-coupled device
CMOS	complementary metal-oxide-semiconductor
IR	infrared radiation
NIR	near-infrared radiation
HeNe	Helium-Neon
ND	neutral density
SORS	Spatially offset Raman spectroscopy
LED	Light emitting diode
PANI	polyanilin
LB	leukoemeraldinová báze
EB	emeraldinová báze
PNB	báze pernigranilin
ES	emeraldinová sůl
pH	potencial of hydrogen (vodíkový exponent)
H ₂ SO ₄	kyselina sírová
HCl	kyselina chlorovodíková
CH ₃ COOH	kyselina octová
AFM	Atomic Force Microscope
SEM	Scanning Electron Microscope

Seznam použitých obrázků

Obrázek 1.1: Schematické znázornění energie rozptýlených fotonů	3
Obrázek 1.2: Schematické znázornění Ramanova spektra	4
Obrázek 1.3: Základní struktury uhlíkových materiálů (grafen - vlevo, grafit - vpravo) [6]	5
Obrázek 1.4: Typické Ramanovo spektrum grafenu a grafitu [podle 7]	6
Obrázek 1.5: Základní struktury diamantu [podle 6]	6
Obrázek 1.6: Typické Ramanovo spektrum diamantu [podle 9]	7
Obrázek 1.7: Středy symetrie molekuly [podle 3].....	8
Obrázek 1.8: Jablonského diagram energetických přechodů během fluorescenčního záření	8
Obrázek 2.1: Obecná schéma Ramanova spektrometru	10
Obrázek 2.2: Rayleighovo kritérium pro dva rozlišitelné body [podle 17].....	11
Obrázek 2.3: Paprsek vstupující do objektivu a vyjádření vztahu pro NA [17].....	12
Obrázek 2.4: Difrakční mřížka [5]	12
Obrázek 2.5: Monochromátor [5].....	13
Obrázek 2.6: Polychromátor [podle 5]	13
Obrázek 3.1: Schematické znázornění konfokálního mikroskopu [31]	16
Obrázek 3.2: Schema konfokálního Ramanova mikroskopu [podle 17].....	17
Obrázek 3.3: Typy skenování vzorku v různých rovinách [podle 17]	17
Obrázek 3.4: Ramanův mikrospektrometr Renishaw InVia Qontor	18
Obrázek 3.5: Excitační lasery	19
Obrázek 3.6: CCD detektor	19
Obrázek 3.7: Dispenzí prvek [podle 17].....	20
Obrázek 3.8: Optická dráha paprsku laseru [podle 14]	21
Obrázek 5.1: Připravené polyanilinové filmy na křemíku (vlevo) a skle (vpravo)	25
Obrázek 5.2: Fotografie filmu polyanilinu připraveného za přítomnosti 0,1 M kyseliny sírové na křemíkové podložce (vlevo - celá plocha, vpravo - měřený bod).....	26
Obrázek 5.3: Ramanovo spektrum filmu PANI-H ₂ SO ₄ připraveného za přítomnosti kyseliny sírové na křemíkové podložce s použitím laseru - 830 nm (černá čara), 633 nm (červená čara), 532 nm (zelená čara).....	26
Obrázek 5.4: Fotografie filmu polyanilinu připraveného za přítomnosti 1 M kyseliny chlorovodíkové na křemíkové podložce (vlevo - celá plocha, vpravo - měřený bod)	29
Obrázek 5.5: Ramanovo spektrum filmu PANI-HCl připraveného za přítomnosti kyseliny chlorovodíkové na křemíkové podložce s použitím laseru - 830 nm (černá čara), 633 nm (červená čara), 532 nm (zelená čara).....	29

Obrázek 5.6: Fotografie filmu polyanilinu připraveného za přítomnosti 0.5 M kyseliny octové na křemíkové podložce (vlevo - celá plocha, vpravo - měřený bod).....	32
Obrázek 5.7: Ramanovo spektrum filmu PANI-CH ₃ COOH připraveného za přítomnosti kyseliny octové na křemíkové podložce s použitím laseru - 830 nm (černá čara), 633 nm (červená čara), 532 nm (zelená čara).....	32
Obrázek 5.8: Ramanovo spektrum filmů PANI-H ₂ SO ₄ , PANI-HCl a PANI-CH ₃ COOH s použitím laseru 830 nm.....	35
Obrázek 5.9: Ramanovo spektrum filmů PANI-H ₂ SO ₄ , PANI-HCl a PANI-CH ₃ COOH s použitím laseru 633 nm.....	36
Obrázek 5.10: Ramanovo spektrum filmů PANI-H ₂ SO ₄ , PANI-HCl a PANI-CH ₃ COOH s použitím laseru 532 nm.....	37
Obrázek 6.1: AFM charakterizace povrchu filmu PANI-H ₂ SO ₄	39
Obrázek 6.2: AFM charakterizace povrchu filmu PANI-HCl.....	40
Obrázek 6.3: AFM charakterizace povrchu filmu PANI-CH ₃ COOH	40
Obrázek 6.4: SEM charakterizace povrchu filmu PANI-H ₂ SO ₄	41
Obrázek 6.5: SEM charakterizace povrchu filmu PANI-HCl	41
Obrázek 6.6: SEM charakterizace povrchu filmu PANI-CH ₃ COOH.....	42
Obrázek 7.1: Fotografie vzorků Micrux s nanesenou vrstvou polyanilinu	43
Obrázek 7.2: V-A charakteristika PANI dopovaného sírovou kyselinou	44
Obrázek 7.3: V-A charakteristika PANI dopovaného chlorovodíkovou kyselinou	44
Obrázek 7.4: V-A charakteristika PANI dopovaného octovou kyselinou.....	45
Obrázek 7.5: Závislost odporu vrstvy na teplotě	45
Obrázek A.1: Míchání roztoků	50
Obrázek A.2: Čištění vzorků v čističce	50
Obrázek A.3: Připravené vodní roztoky a vzorky v prázdné baňce	51
Obrázek A.4: Barevní změny během polymerizace PANI-HCl.....	51
Obrázek B.1: Vnitřní vybavení Renishaw inVia Qontor Ramanova spektrometru	52
Obrázek B.2: Softwarové prostředí WiRe TM	52
Obrázek B.3: Ramanovo spektrum bez fitování píků.....	53
Obrázek B.4: Ramanovo spektrum s fitováním píků.....	53
Obrázek C.1: Pracoviště pro měření s mikroskopem AFM Ntegra NT-MDT	54
Obrázek C.2: Nastavení paprsku laseru.....	54
Obrázek C.3: Softwarové prostředí pro živé sledování pohybu hrotu	55
Obrázek C.4: Softwarové prostředí pro nastavení parametrů měření	55
Obrázek D.1: Hrotová měřící stanice CASCADE MicroTech M150	56

Obrázek D.2: Parametrický analyzátor Agilent 4156C	56
Obrázek D.3: Měření vodivosti filmu PANI-H ₂ SO ₄ na elektrodách Micrux	57
Obrázek D.4: Měření vodivosti filmu PANI-HCl na elektrodách Micrux	57
Obrázek D.5: Měření vodivosti filmu PANI-CH ₃ COOH na elektrodách Micrux	58
Obrázek D.6: Softwarové okno aplikace Agilent EasyExpert pro měření V-A charakteristiky	58

Seznam použitých tabulek

Tabulka 5.1: Ramanův posuv PANI-H ₂ SO ₄ (vlastní měření a převzata z literatury).....	28
Tabulka 5.2: Ramanův posuv PANI-HCl (vlastní měření a převzata z literatury).....	31
Tabulka 5.3: Ramanův posuv PANI-CH ₃ COOH (vlastní měření a převzata z literatury) ..	34

Úvod

Optické spektroskopické metody se v současné době používají k získání informací o elektronických a vibračních stavech v dopovaném i nedopovaném stavu a o povaze strukturních defektů ve vodivých polymerech. Ramanova spektroskopie je jednou z metod vibrační molekulové spektroskopie, která se používá k chemické identifikaci materiálů obsažených ve vzorku.

Jednotlivé spektrální linie v molekulových spektrech vznikají při absorpci, emisi nebo rozptylu fotonů v souvislosti se změnou energie molekuly. Na rozdíl od atomové spektroskopie se energie molekuly může měnit nejen jako důsledek elektronových přechodů, ale také při rotačních a vibračních změnách stavů molekuly. Molekulová spektra jsou mnohem složitější než atomová, ale zároveň obsahují více informací o různých vlastnostech studované látky. Vibrační spektra vzorku pak vykazují rysy příslušející rotačním přechodům, které doprovázejí excitaci vibračních stavů.

Cílem této práce je seznámit čtenáře se základy Ramanovy spektroskopie, popsat Ramanův jev a provést podrobnou rešerši komponent spektroskopických přístrojů, následovně provést praktické ověření této metody na syntézováných vzorcích, zaměřit se na problematiku dopování vodivých polymerů a popsat jeho vliv na morfologie povrchu a elektrickou vodivost materiálů.

Cíle této práce:

- Studium teoretických základů Ramanovy spektroskopie a její aplikace pro analýzu tenkých vrstev organických polovodičů
- Pro vybraný organický polovodič provést jeho syntézu a vytvořit sadu testovacích vzorků
- Připravené vzorky analyzovat pomocí Ramanova spektrometru a výsledky porovnat s výsledky publikovanými v posledních letech
- Provést AFM, SEM a základní elektrickou charakterizace

1 Ramanova spektroskopie

Ramanova spektroskopie je analytická nedestruktivní metoda, která se řadí mezi optické metody. Optické metody obecně využívají reakce elektromagnetického záření a konkrétně Ramanova spektroskopie je metoda, založená na změně záření při průchodu vzorkem a poskytuje informace o vnitromolekulárních a mezimolekulárních vibracích. Muže přinést doplňující poznatky o reakci a tím poskytuje spektrální charakteristiku specifických vibrací molekuly, což představuje informaci pro identifikaci látky. Také dokáže poskytnout navíc i doplňující informaci o módech za nižších frekvencí a o vibracích a tím je možné získat informace o krystalické mřížce a páteřní struktuře molekuly. Ramanova spektroskopie má rychlý průběh, jehož výsledkem je Ramanovo spektrum, pomocí kterého zjišťujeme kvalitativní i kvantitativní informace o zkoumané látce. Analyzovaná látka může být původem anorganická i organická a ve skupenství plynném, kapalném nebo pevném [1][4].

1.1 Princip metody

Podstatou principu Ramanovy spektroskopie je ozáření vzorku monochromatickým zářením z laserového zdroje, na základě kterého vzniká rozptyl záření a současné změny vibračních a rotačních stavů molekul vzorku. Při interakci záření s molekulami ve vzorku se většina fotonu rozptýlí se stejnou energii jako dopadající fotony, ale malé množství těch fotonu se rozptýlí při odlišné frekvenci, než je frekvence dopadajících fotonu. Znamená to, že energie alespoň jedné z částic nezůstane zachována. Tento proces se nazývá neelastický rozptyl nebo Ramanův jev.

Neelastický rozptyl byl předpovězen v roce 1923 rakouským fyzikem Adolphem G. S. Smekalem a potvrdil jej o několik let později v roce 1928 indický fyzik Sir Chandrasekhara Venkata Raman pomocí rozptýlu slunečního záření na molekulách vody. V roce 1930 Sir Raman obdržel za experimentální objev Ramanova jevu Nobelovu cenu za fyziku. Ten jev umožňuje získat vibrační signaturu molekuly, a tak můžeme poznat její strukturu a způsob interakce s ostatními molekulami v okolí [2].

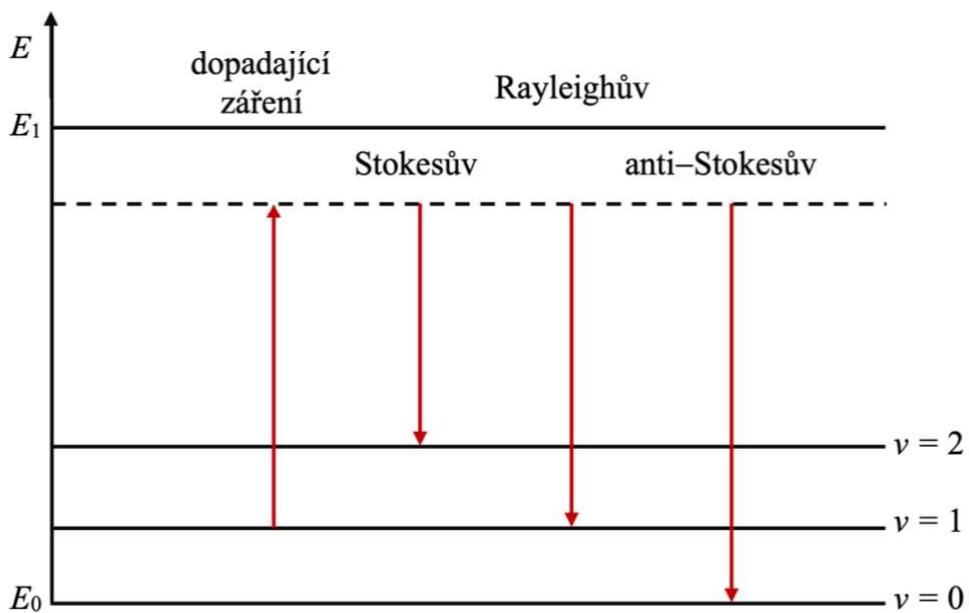
1.1.1 Ramanův rozptyl

Ramanův rozptyl je neelastický rozptyl fotonů molekulárními vazbami, kde je podstatou zářivý dvoufotonový přechod mezi dvěma stacionárními vibračními stavů molekuly, které mají energie E_1 a E_2 , vyvolány interakcí s fotonem dopadajícím záření o frekvenci ν_0 ,

provázeny vyzářením fotonu rozptylového záření o frekvenci ν_R . Můžeme to představit jako absorpci dopadajícího záření v závislosti na jeho měničí se frekvencí. Celý proces může být formálně považován za excitaci molekuly z výchozího stavu do širšího pásmá nevlastních stavů s navazujícím návratem do nižšího energetického stavu, kdy čistá energetická změna je nesena rozptylovým fotonem za splnění podmínky zachování energie:

$$h\nu_R = h\nu_0 \pm (E_1 - E_2). \quad (1.1)$$

V tomto případě rozptylu je malá část dopadajících fotonů ($\sim 1 \text{ z } 10^7$) interaguje s molekulami tak, že jim část energie předá a je pak provozován na nižší energii. Energetický rozdíl mezi dopadajícími a rozptýlenými fotony je Ramanův posun a odpovídá energii molekulárních vibrací. Hodnota Ramanova posunu je nezávislá na energii (vlnové délce) laseru. Takto rozptýlené fotony tvoří záření o nižších frekvencích a je to Stokesův rozptyl. Jiné dopadající fotony mohou naopak přijímat energii od molekul, pokud ty jsou v excitovaném stavu, a při přechodu na vyšší energetický virtuální stav mohou uvolňovat do konečného energetického stavu, který je nižší, než byl počáteční. Důsledkem je záření o kratší vlnové délce označované jako anti-Stokesův rozptyl. Složka záření rozptýlená bez frekvenční změny se nazývá Rayleighův rozptyl (Obr. 1.1). Detekce těchto rozptýlených fotonů poskytuje spektrum Ramanových pásů, z nichž každý je charakteristický pro konkrétní molekulární vazbu [2][3].



Obrázek 1.1: Schematické znázornění energie rozptýlených fotonů

1.2 Ramanovo spektrum

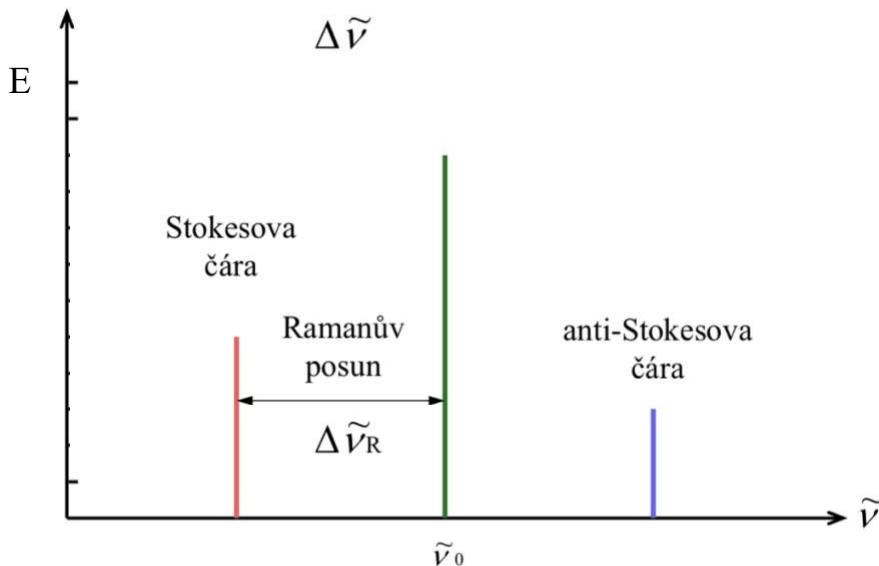
Ramanovo spektrum je vibračním spektrem molekuly a vyjadřuje intenzitu rozptýlených fotonů, která odpovídá rozdílu energií mezi rozptýleným a excitačním zářením, v závislosti na vlnové délce (Obr. 1.2). Čárám Ramanova spektra lze přiřadit určité vibrace v molekulách vzorku. Intenzita signálu je úměrná polarizovatelnosti molekuly při odpovídající vibraci vazby nebo seskupení vazeb [2].

Pro lepší přehled jednotlivých spekter používáme závislost intenzity záření na vlnočtů - převrácených hodnotách vlnových délek, což je počet vln na jednotku délky. Pro jejich přepočet lze využít rovnici:

$$\tilde{v} = \frac{1}{\lambda}, \quad (1.2)$$

kde \tilde{v} (cm^{-1}) je vlnočet - udává počet vln připadajících na dráhu 1 cm, λ je vlnová délka záření [3].

Intenzita Ramanových spekter je stejně jako intenzita rozptýleného záření nepřímo úměrná vlnovému číslu dopadajícího záření. Ramanovy linie jsou rozloženy symetricky na obou stranách excitační frekvence kolem čar Rayleighova rozptylu (ve Stokesově a v anti-Stokesově oblasti). V praxe jsou však měřena spektra pouze v oblasti Stokesova rozptylu, a to s ohledem na nutnost odfiltrovat Rayleighův rozptyl. Anti-Stokesovy čáry pak mají mnohem nižší intenzitu než Stokesovy a vznikají za normální teploty pouze u vibracích s vlnočtem do 700 cm^{-1} .



Obrázek 1.2: Schematické znázornění Ramanova spektra

Z hlediska kvalitativní informace můžeme srovnávat naměřená spektra různých vzorku s databází spekter, a tak určovat neznámé látky. Ramanovo spektrum je pro identifikaci materiálu výborným „otiskem prstě“, zejména je-li při porovnávání změřených a databázových dat dodržena podmínka, že Ramanova spektra byla získána pro stejný fyzikální stav látky. Různě rozsáhlé databáze spekter jsou dostupné komerčně, avšak často je vhodné vytvářet jednoúčelové knihovny spekter zpracováním vlastních naměřených dat.

Ramanova spektra se dále využívají i z hlediska kvantitativní analýzy. Vzorky mohou být změřeny ve skleněných a některých dalších transparentních dózách a obvykle není potřeba provádět žádnou speciální úpravu vzorku. Optické materiály, které používáme v Ramanově spektroskopii nejsou tak citlivé na vlhkost. Ale mnohem časově náročnější a pracnější než provádění samotných měření spekter je následné zpracování a hodnocení namerených dat [2][3][5].

1.2.1 Ramanovo spektrum uhlíkových materiálů

V této podkapitole budou ukázána a popsána Ramanova spektra různých materiálů na bázi uhlíku.

Grafen je materiál vytvořený z jedné vrstvy atomů uhlíků, které jsou uspořádány do pravidelné struktury šestiúhelníku. Je téměř neustále zkoumán pro své výjimečné vlastnosti, ať už mechanické, optické nebo elektické. Vrstva grafenu je považována za dvourozměrnou strukturu a tím tvoří základ pro vytvoření různých uhlíkových struktur v jiných dimenzích. Běžné přirozeně allotropy uhlíku sp^2 a sp^3 se vyskytují v různých krystalografických formách podobných grafitu a diamantu: hexagonální grafit a krychlový diamant (Obr. 1.3 a Obr. 1.5) [6].

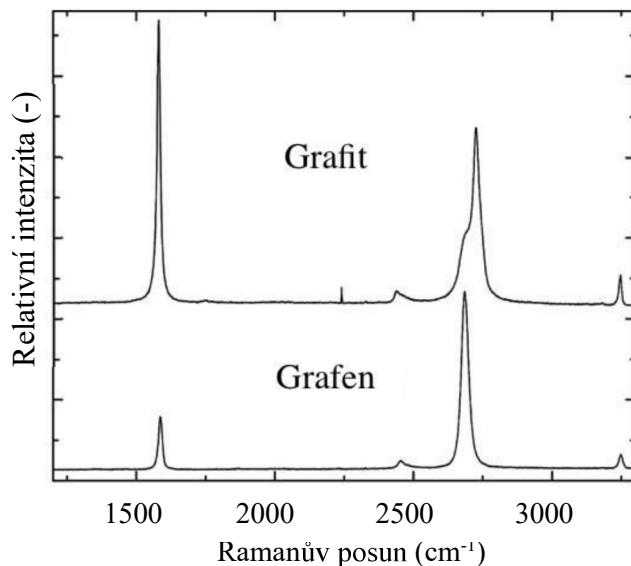


Obrázek 1.3: Základní struktury uhlíkových materiálů (grafen - vlevo, grafit - vpravo) [6]

Mezi základní vibrační módy, které pozorujeme v Ramanově spektru všech uhlíkových materiálů, jsou páky D, G a 2D. Jejich pozice a parametry (intenzita, vlnočet, šířka piku) jsou ovlivněny dalšími faktory, jako je počet grafenových vrstev, napětí a budicí výkon laseru. Dalším důležitým módem je skupina pásů RBM (dýchací mód), který se

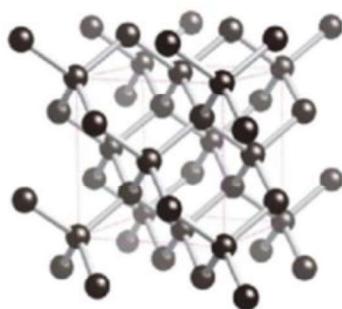
vyskytuje jen v Ramanových spektrech uhlíkových nanotubiček.

D-pík se nachází přibližně na hodnotě 1350 cm^{-1} a jeho přítomnost ve spektru značí defekty, jehož intenzita odráží míru poškození struktury grafenu. Kvalitní grafenové vrstvy ve svých spektrech ten pík nemají. G-pík se vyskytuje přibližně na 1590 cm^{-1} a 2D-pík na pozici asi 2700 cm^{-1} . Přesné polohy píků a jejich tvary vždy závisí na substrátu, na kterém máme grafen umístěny. Posuv 2D-píku k vyšším hodnotám je způsoben napětím mezi grafenovou vrstvou a substrátem. U jedné vrstvy grafenu pozorujeme větší intenzitu 2D-píku než G-píku (Obr. 1.4). Ramanovo spektrum krystalického grafitu je téměř shodné se spektrem grafenu [7].



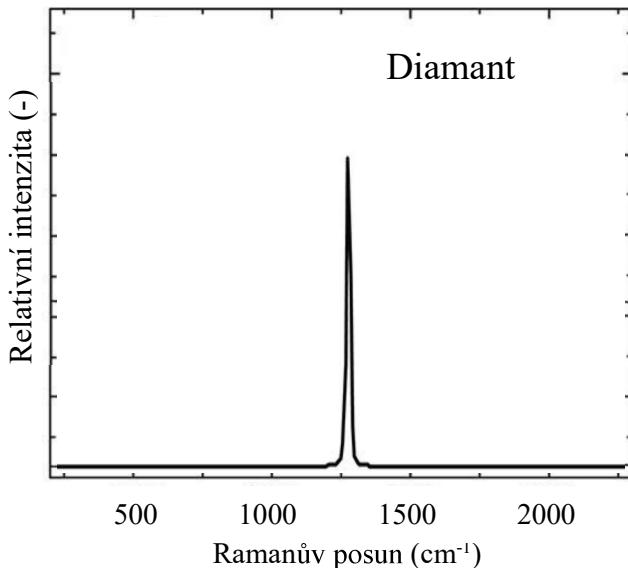
Obrázek 1.4: Typické Ramanovo spektrum grafenu a grafitu [podle 7]

Diamant je polymorf čistého krystalického uhlíku a má krychlovou soustavu se symetrií. Tetraedrické uspořádání atomů je příčinou nejvyšší tvrdosti mezi všemi přírodními materiály [8].



Obrázek 1.5: Základní struktury diamantu [podle 6]

Nejvýraznějším rysem Ramanova spektra prvního řádu diamantu je ostrý dominantní pík v oblasti 1333 cm^{-1} (na Obr. 1.6), a to protože čtyřboká mřížka je symetrická a všechny atomy uhlíku a spojovací vazby jsou ekvivalentní. Další módy se vyskytují ve spektru diamantu se zmenšující se krystalinitou, konkrétně G-pík a široké pásy asi na 500 cm^{-1} a 1200 cm^{-1} [9].

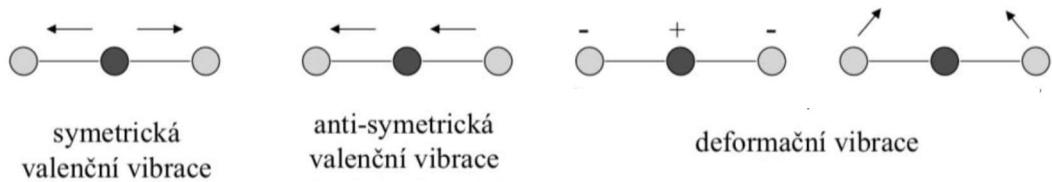


Obrázek 1.6: Typické Ramanovo spektrum diamantu [podle 9]

1.2.2 Vibrace molekul

Pro zobrazení Ramanové linie ve spektru je nutné, aby při vibraci docházelo ke změně tensoru polarizovatelnosti molekuly. Polarizovatelnost popisuje deformovatelnost elektronové hustoty v okolí molekuly působením elektrického pole generovaného fotonem. Intenzita pásů Ramanova spektra je úměrná druhé mocnině změny polarizovatelnosti během vibračního pohybu [3][4].

U malých molekul mohou být Ramanovy a infračervené aktivity spektra často určeny jednoduchou kontrolou typu vibrací (Obr. 1.7). U molekul, které mají střed symetrie, pravidlo vzájemného vyloučení uvádí, že jak v Ramanově, tak v infračerveném spektru nemohou být aktivní žádné vibrační módy. U molekul se středem symetrie vibrace jsou inaktivní v infračerveném spektru, ale v Ramanově spektru jsou aktivní. A naopak u antisymetrických vibrací je Raman inaktivní, ale může být aktivní IR, protože může dojít ke změně dipólového momentu. U molekul bez centra symetrie mohou být některé vibrační módy aktivní v Ramanově i IR spektru. Molekuly, které nemají střed symetrie, mohou mít jiné vhodné prvky symetrie, takže některé vibrační módy budou aktivní pouze v Ramanově nebo pouze v IR spektru [3][4].



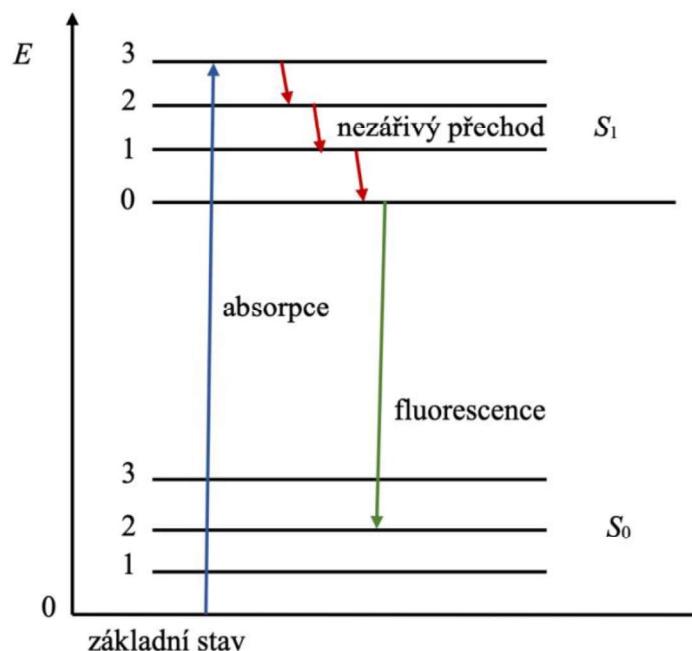
Obrázek 1.7: Středy symetrie molekuly [podle 3]

1.2.3 Fluorescence

Fluorescenční interference hraje velkou roli v Ramanově spektrometrii a se jedná o doprovodný jev, který vzniká při měření Ramanových spekter a může být důsledkem analyzované sloučeniny nebo fluorescenčních nečistot ve vzorku.

Je to absorpční proces, který způsobuje excitaci molekul do vyššího energetického stavu, který vyžaduje fotony s vyšší energií. Fluorescenční záření je poté emitováno, zatímco molekuly se uvolňují zpět na nižší energetickou úroveň. Tento jev silně závisí na excitační vlnové délce a objevuje se pouze na určité frekvenci.

Jablonského diagram popisuje postupné uvolňování záření a přechod molekuly z vyšších excitovaných stavů do počátečního energetického stavu. Následující diagram na Obr. 1.8 ukazuje, jak dochází k fluorescenci v důsledku relaxace určitých excitovaných elektronů molekuly [5][10].



Obrázek 1.8: Jablonského diagram energetických přechodů během fluorescenčního záření

Z diagramu je vidět, že poté, co elektron absorbuje vysokoenergetický foton, dochází ke změně vibračního a rotačního stavu molekuly a je systém excitován na vyšší energetickou hladinu. Molekula vibračně relaxuje a se postupně uvolňuje z excitovaného stavu a ve formě fotonu vyzaruje fluorescenční záření o delší vlnové délce [5][10].

Podle Stokesova zákona je frekvence fluorescenčního záření vždy menší nebo stejná jako frekvence excitačního záření. Stokesovy čáry ve fluorescenci jsou tedy ty, které odpovídají Stokesovemu zákonu, a anti-Stokesovy čáry jsou ty, které mu odporují. Tato nomenklatura byla také přijata i pro Ramanův jev [2].

1.3 Aplikace Ramanovy spektroskopie

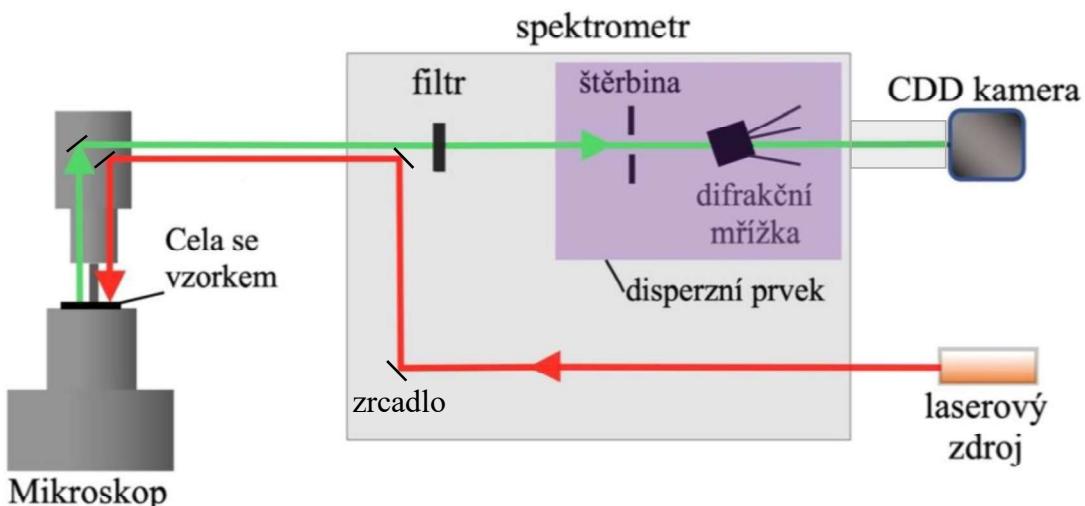
V praxi se uplatňuje v nejrůznějších oblastech, například pro analýzy v přírodních vědách, ve farmaceutickém, kosmetickém či chemickém průmyslu, dále se aplikuje v geologii, také pro rozboru uměleckých děl a kovových slitin. Ramanova spektroskopie je vhodná pro analýzu struktury i ke stanovení složek vzorku. Tato metoda poskytuje strukturní informace o analyzovaných organických i anorganických látkách ve všech skupenstvích. Používá se při analýze pevných látek (krystalické i amorfni materiály, kovy, polovodiče, polymery atp.), kapalin (čisté látky, roztoky vodné i nevodné), plynů, povrchů nebo biologických systémů. Pomocí měření molekulárních vibrací podává informace o chemickém složení a morfologii zkoumaného materiálu s velmi vysokým rozlišením a poskytuje zejména přesný topografický profil povrchu.

Na rozdíl od infračervené spektroskopie lze pomocí Ramanovy spektroskopie provést charakterizace technicky významné prvkových materiálů (uhlíkových materiálů jako grafitické vrstvy, saze, přírodní i umělé diamanty a křemíkových materiálů). Umožňuje široké využití pro strukturní analýzu (rozlišení polymorfů, velikosti krystalů, kvantitativní analýzu směsí účinných a pomocných látek, studium nanočástic), složení, čistotu, mechanické vlastnosti látky. Systém je velmi citlivý na různé změny v materiálu, tím dokáže provést diagnostiku defektu, mechanických pnutí, jemných posuvů.

Ramanovo spektrum v celém rozsahu poskytuje informace nejen o identitě, složení, struktuře a konformaci biologických vzorků, ale také o interakcích mezi makromolekulami, například interakce DNA - protein nebo protein-lipid [4][5].

2 Instrumentace v Ramanově spektroskopii

Spektrometr je obdobný přístroj, který používají všechny spektroskopické techniky a měří charakteristické vlastnosti záření rozptylového, emitovaného nebo absorbovaného molekulami. Základní uspořádání Ramanova spektrometru ukazuje Obr. 2.1. Excitační monochromatické záření, kterým je zejména laser se stabilizovanou vlnovou délkou, je zaostřeno pomocí objektivu mikroskopu do malého místa vzorku a nejmenší možná velikost tohoto excitovaného objemu je dána Rayleighovým kritériem. Filtr odstraní záření o stejné vlnové délce jaké má laserový paprsek a ponechá jen nepružně rozptylené záření odlišné vlnové délky (s Ramanovým posunem). Spektrální informace je pak analyzována disperzním prvkem (ten rozdělí záření podle vlnové délky), a dále rozdělené fotony dopadají na detektor (CCD kamera), který detekuje intenzitu dopadajícího záření v závislosti na vlnové délce. Z naměřených hodnot výsledkem je spektrum zobrazující intenzitu záření u každé vlnové délky [5].



Obrázek 2.1: Obecná schéma Ramanova spektrometru

2.1 Zdroj excitační energie

Zdrojem monochromatického záření se nejčastěji používá plynový laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), který zajistí intenzivní záření, protože Ramanův rozptyl je velmi slabý. Intenzita Ramanova rozptylu je úměrná v^4 , kde v je frekvence excitačního záření. Laser má úzké spektrální čáry, velmi intenzivní a koherentní

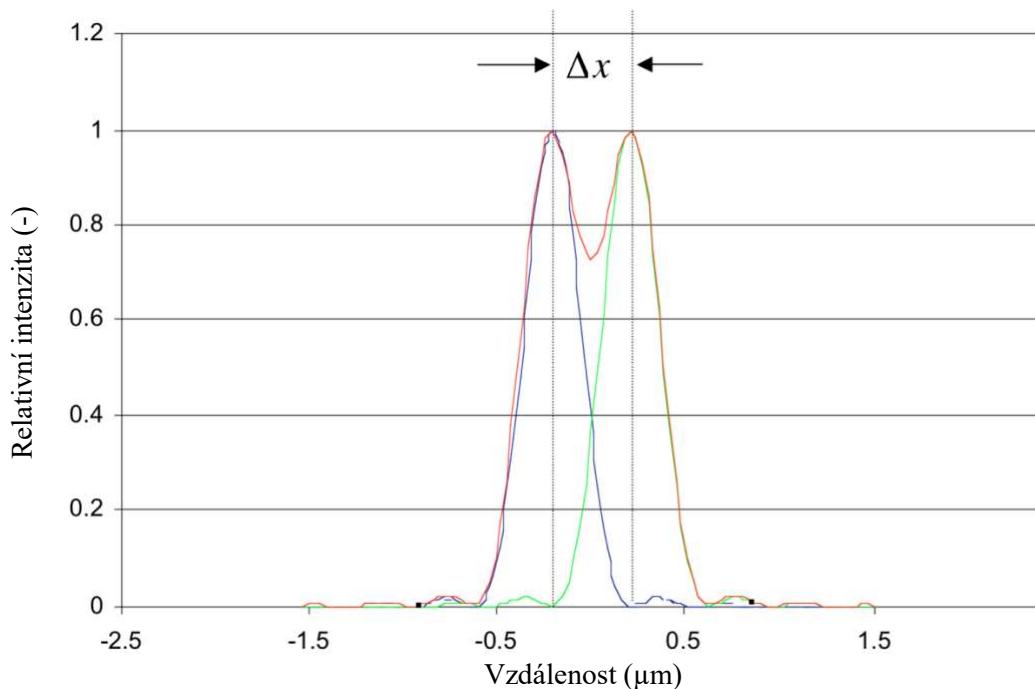
paprsek (průměr svazku cca 1 mm, divergence 0,6 mrad), a používá výkon nejčastěji 0,2-4 W, výjimečně i více než 10 W [5].

Velikost zaostřeného bodu laserem nemusí nutně definovat laterální prostorové rozlišení Ramanova systému. Laterální prostorové rozlišení je často diskutováno z hlediska Rayleighova kritéria. Podle Rayleighova kriteria kratší vlnová délka buducího záření je spojena s vyšším laterálním rozlišením a to bez ohledu na kvalitu laserového záření a vlnoplochu nebo velikost paprsku (1.3):

$$\Delta x = 0,61 \cdot \lambda / NA_{obj}, \quad (2.1)$$

kde λ je vlnová délka, NA je numerická apertura použitého objektivu a Δx je laterální rozlišení pro veličinu λ . Hodnota Δx uvádí vzdálenost mezi dvěma rozlišitelnými body (Obr. 2.2).

Rayleighovo kritérium vyžaduje, aby vzdálenost mezi dvěma bodovými zdroji světla stejné intenzity byla větší než vzdálenost od maxima k minimu prvního vzdušného disku. K úplné diskriminaci dvou sousedních materiálů dochází při dvojnásobku Rayleighova kritéria [17].

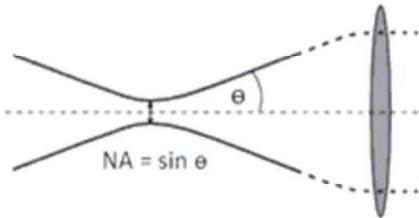


Obrázek 2.2: Rayleighovo kritérium pro dva rozlišitelné body [podle 17]

Rayleighovo kriterium také uvádí důležitost numerické apertury, která ukazuje účinnou světlost objektivu, a je ovlivněna indexem lomu prostředí mezi objektivem a vzorkem. Je to bezrozměrné číslo, které lze vyjádřit zápisem (2.2):

$$NA = n \cdot \sin \theta, \quad (2.2)$$

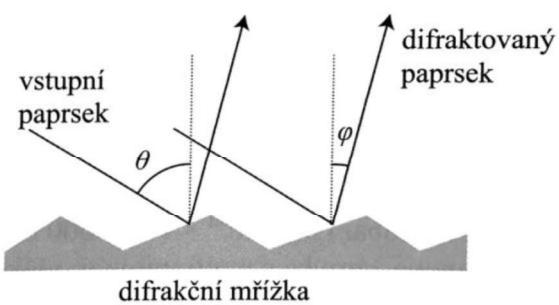
kde n je index lomu prostředí před objektivem a θ je polovina vrcholového úhlu kuželev paprsků vstupujících do objektivu (jeho poloviční úhlová apertura) (Obr. 2.3):



Obrázek 2.3: Paprsek vstupující do objektivu a vyjádření vztahu pro NA [17]

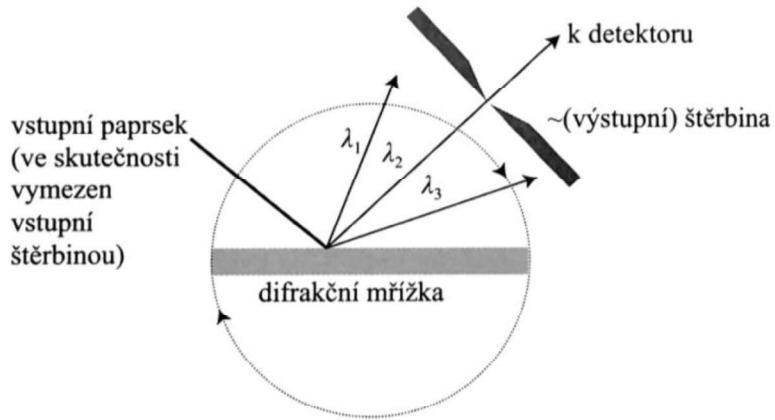
2.2 Disperzní prvek

Disperzním prvkem ve většině absorpčních spektrometru je difrakční mřížka, která umožňuje prostorové oddělit záření různých vlnových délek jako důsledek difrakce světla. Je tvořena skleněnou nebo keramickou deskou, kde jsou vyryty drážky pokryté reflexním povlakem. Mřížka působí interference mezi vlnami odráženými od jejího povrchu. Když polychromatický paprsek dopadá na povrch pod úhlem θ , několik světelných paprsků o různých vlnových délkah se objevuje pod různými úhly φ (Obr. 2.4).



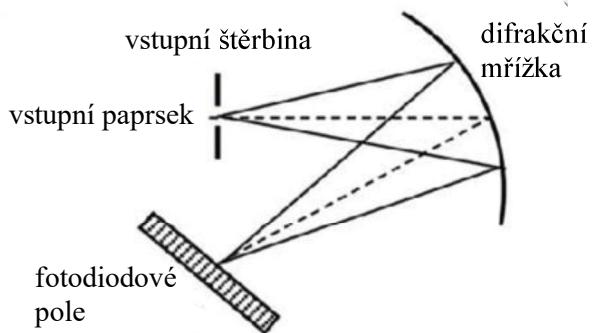
Obrázek 2.4: Difrakční mřížka [5]

V monochromátoru (Obr. 2.5) záření prochází úzkou výstupní štěrbinou, která umožňuje, že na detektor dopadá pouze velmi úzký interval vlnových délek. Při použití monochromátoru zaznamenáváme absorpční spektrum „bod po bodu“ a tím získáme odezvy v jednotlivých polohách mřížky vůči detektoru.



Obrázek 2.5: Monochromátor [5]

V polychromátoru (Obr. 2.6) se nepoužívá výstupní štěrbina a vybraný rozsah vlnových délek je simultánně snímán řadou detektorů nebo detektorovým polem [5].



Obrázek 2.6: Polychromátor [podle 5]

2.3 Detektor

Detektor je zařízení, které převádí dopadající záření na energii elektrického signálu a využívá fyzikálního jevu známého jako fotoefekt. Muže být jednokanálový, nebo mnohokanálový, s velkým počtem pixelů uspořádaných v jednorozměrné řadě (diodová pole), nebo ve dvojrozměrném poli (detektory CCD, CMOS). Důležitou vlastností detektoru je jeho kvantová účinnost, která vyjadřuje procento detekovaných fotonů z celkového počtu dopadajících na detektor fotonů.

CCD (Charge-Coupled Device) detektor je tvořen několika miliony malých fotodiodových detektorů. Pomoci detektoru CCD je možné detektovat simultánně záření v širokém rozsahu vlnových délek, která se objevuje na výstupu monochromátoru čí

polychromátoru. Detektor CCD se využívá velmi široce jako snímač obrazu a detektor v řadě absorpčních a emisních spektrometřech a v Ramanových spektrometřech [5].

3 Ramanův mikroskop

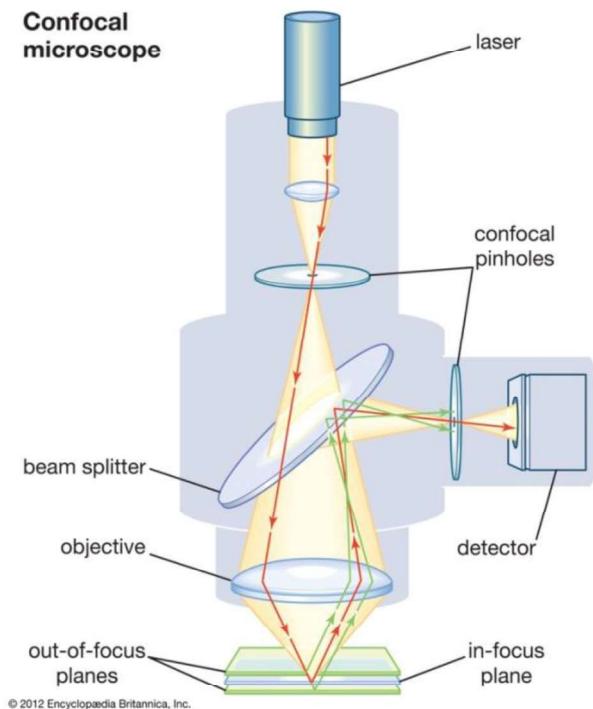
3.1 Konfokální mikroskop

Konfokální mikroskopie je charakterizována lepším rozlišením ve směru kolmém k rovině pozorování, potlačením rušivého záření z nezaostřených částí studovaného vzorku a kontrastem vyšším než u ostatních metod. Konfokální mikroskopie umožňuje snímání sérií optických řezů, které jsou navíc přesně slícované a jejichž skládáním lze rekonstruovat pozorovaný objekt ve 2,5D projekci a provést analýzu mikroskopických struktur. To souvisí s vysokými nároky na komplexní provoz, konkrétně s technickým vybavením a výkonem PC. Předností a zároveň omezením metody je využití laserového zdroje záření, protože intenzivní osvětlení vzorku přispívá k tepelnému namáhaní, což vede k degradaci vzorku nejen v místě snímání, ale i v místech kam paprsek prochází k místu zaostření [11][12][13].

Při pozorování v konfokálním mikroskopu (Obr. 3.1) je zkoumaný vzorek ozářen laserovým paprskem zaostřeným na tzv. první konfokální clonku, kterou objektiv mikroskopu zobrazí do bodu uvnitř vzorku. Odtud záření odražené vzorkem nebo emitované fluorescencí prochází zpět přes objektiv a tvoří další obraz této bodové clonky v zadní ohniskové rovině, kde je umístěna druhá konfokální clonka. Protože fotonásobič se nachází až za konfokální clonkou, ta zabrání průchodu záření z nezaostřených míst a tak odstraní příčinu rozmazání obrazu při pozorování tlustších vzorků klasickým optickým mikroskopem [11][12][13].

Konfokální mikroskopie má hodně výhod, včetně zvýšení optického rozlišení a kontrastu obrazu vzorku, usnadnění rekonstrukce 3D obrazů, umožňující sběr sériových optických řezů buněk, a tím se dozvědět jakou vzájemnou polohu mají různé komponenty, a využití v mnoha biologických oblastech, např. v buněčné a molekulární biologii a ve fyziologii. Omezení konfokální mikroskopie zahrnují hloubku zobrazení v tlustých vzorcích a náklady ve srovnání s konvenčními mikroskopy. Problémy fluorescenční sondy a fototoxicity vlastní konvenční fluorescenční mikroskopie jsou také přítomny v konfokální mikroskopii. Technologie pro mikroskopii jsou slibné a stále se zdokonalují. Digitální obrazy sérií optických řezů implementují data vhodná pro kvantitativní analýzu i pro počítačové trojrozměrné rekonstrukce velkých oblastí povrchu [11][12][13].

Konfokální mikroskop je zvláště vhodný pro nově vznikající aplikace v mikro a nano technologických oblastech, které kladou vyšší nároky na moderní způsoby bezkontaktního měření a kontroly struktury materiálu, velmi jemných spojů a také na kontrolu drsnosti povrchů se submikronovou rozlišovací schopnosti ve 3D [14].

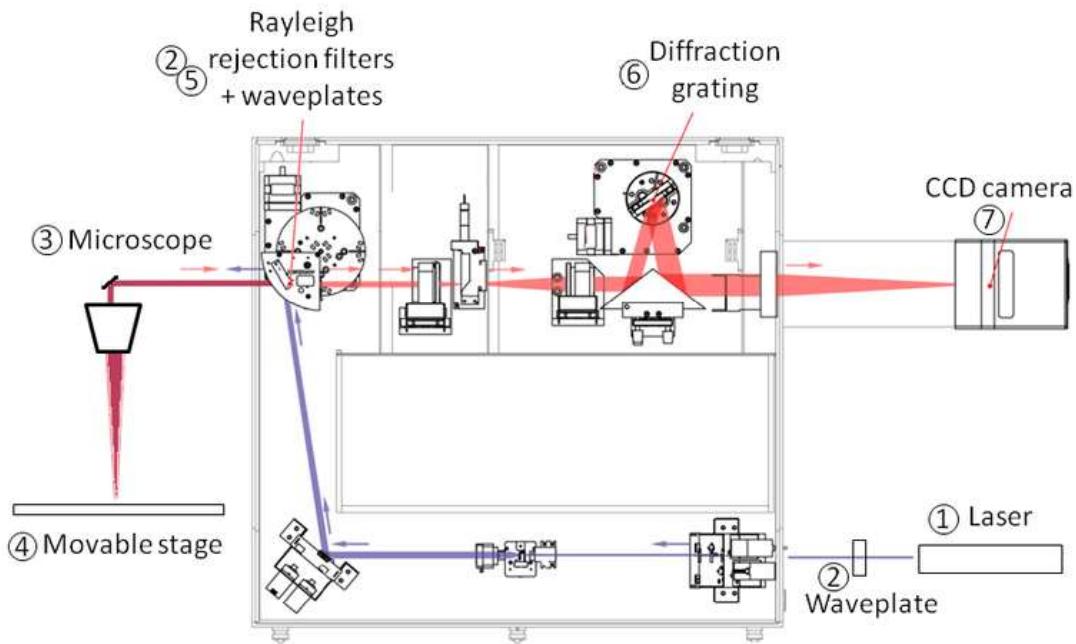


Obrázek 3.1: Schematické znázornění konfokálního mikroskopu [31]

3.2 Konfokální Ramanův mikroskop

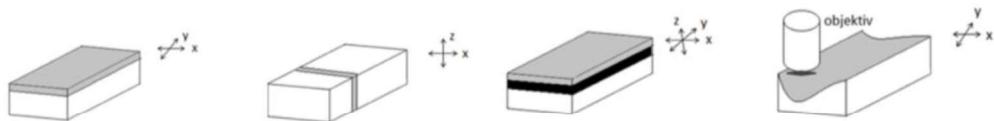
Konfokální Ramanova mikroskopie integruje Ramanovou spektroskopie a standardní zobrazovací optickou techniku do jednoho systému (Obr. 3.2), který umožňuje dosažení vysokého rozlišení mikroskopické a citlivosti spektroskopické metody. Tento nástroj nám umožňuje vizualizovat vzorek pod sondou při různém zvětšení a provádět Ramanovou analýzu na mikroskopické úrovni. Prostorové rozlišení systému závisí na laserovém zdroji, vlnové délce a typu objektivu mikroskopu zvoleného pro analýzy [15][16][17].

Počátky této metody jsou datovány ještě ke konci minulého století, kdy byl poprvé zkonstruován Ramanův spektrometr v kombinaci s konfokálním optickým mikroskopem. Mikrospektrometr byl využíván k fokusaci budicího záření na určitý bod na vzorku o průměru několika mikronů. Další inovaci v systému stalo použití krokového motoru, který umožnil skenování určité oblasti pohybem vzorku. Na Obr. 3.2 je schematicky zobrazená vnitřní konstrukce konfokálního Ramanova mikroskopu [15][16][17].



Obrázek 3.2: Schema konfokálního Ramanova mikroskopu [podle 17]

Další funkce, kterou konfokální uspořádání umožňuje, je zobrazení spektra v různých rovinách povrchu (na Obr. 3.3). Tato technika je extrémně výkonnou analytickou metodou, která má řadu aplikací v různých vědeckých oborech svým poskytováním trojrozměrného prostorového měření pro analýzu vzorku v osách XY (laterální) a Z (hloubka) a zobrazuje buňky jako kombinace povrchového skenování a hloubkového profilování [17].



Obrázek 3.3: Typy skenování vzorku v různých rovinách [podle 17]

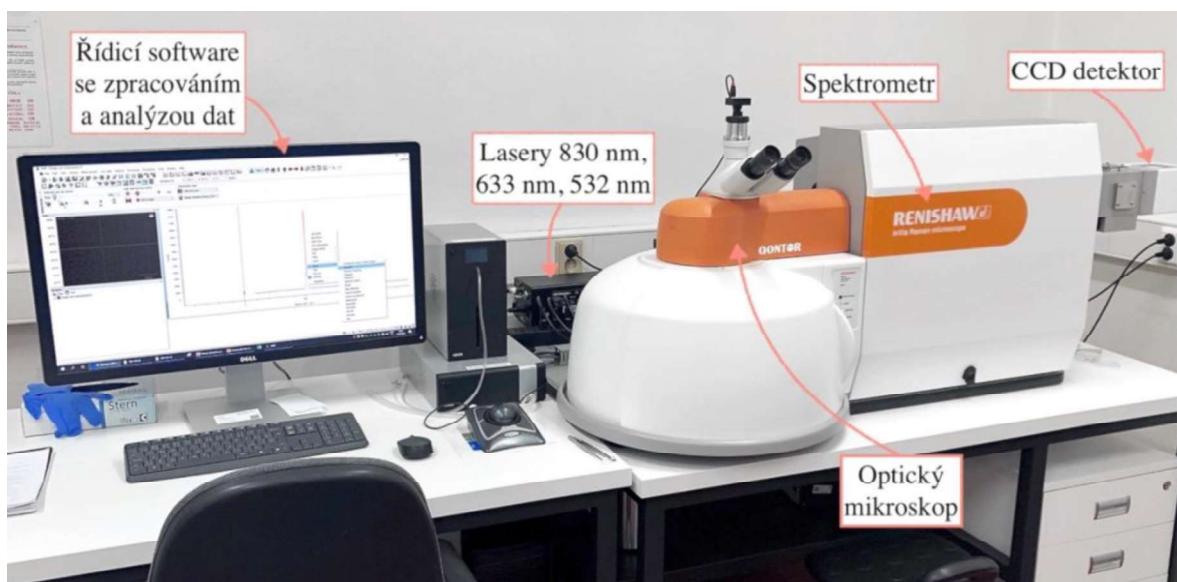
Konfokalita významně omezuje negativní vliv fluorescence při detekování Ramanova rozptýlu. Při interakci záření s molekulou se vyskytuje s větší pravděpodobností než Ramanův rozptyl. Proto musíme maximálně ten vliv redukovat. Konfokální uspořádání přispívá k redukci vlivu fluorescence z oblastí vzorku mimo oblast fokusace laserového paprsku [15][16][17].

3.3 Renishaw inVia Qontor Ramanův mikrospektrometr

3.3.1 Hardwarové ovládání

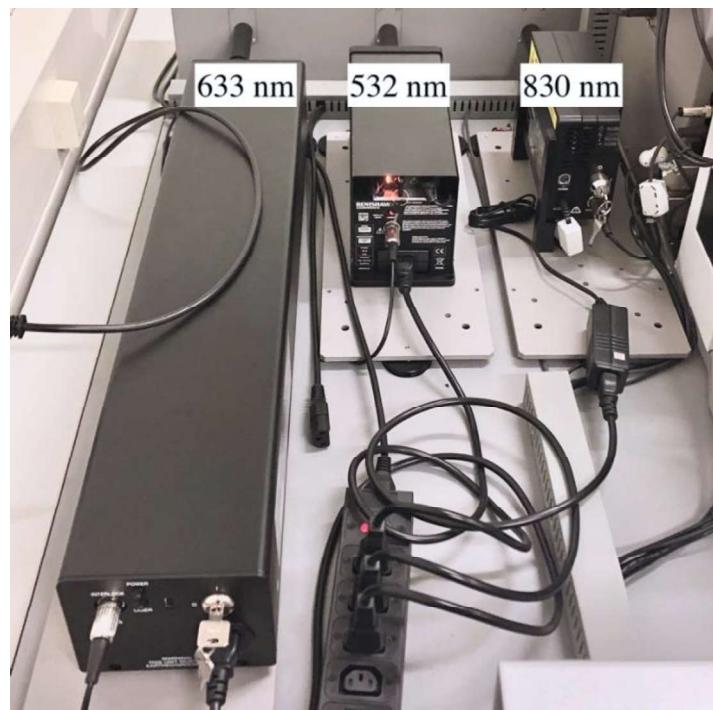
Renishaw inVia Qontor Ramanův mikrospektrometr (Obr. 3.4) je vysoce automatizovaný konfokální disperzní mikrospektrometr umožňující konfokální měření Ramanových a fotoluminiscenčních spekter.

Přístroj umí automatické kalibrovat difrakční mřížky, seřídit optické cesty samotných laserů a provést optimalizace aktivní plochy CCD detektoru.



Obrázek 3.4: Ramanův mikrospektrometr Renishaw InVia Qontor

Spektrometr využívá samostatně definované optické dráhy optimalizované pro každý z excitačních laserů na Obr. 3.5 (Renishaw NIR polovodičový 830 nm o výkonu 300 mW, Renishaw HeNe 633nm o výkonu 17 mW a diodový 532 nm o výkonu 50 mW) pro dosažení vysoké kvality získaných Ramanových spekter ve smyslu rozlišení a odstupu signálu od šumu. Po zapnutí se však musí laser určitou dobu tepelně stabilizovat, aby byl jeho výkon konstantní. Pro propojení laserů nejsou použita optická vlákna a tím nedochází k vysokým optickým ztrátám [17].



Obrázek 3.5: Excitační lasery

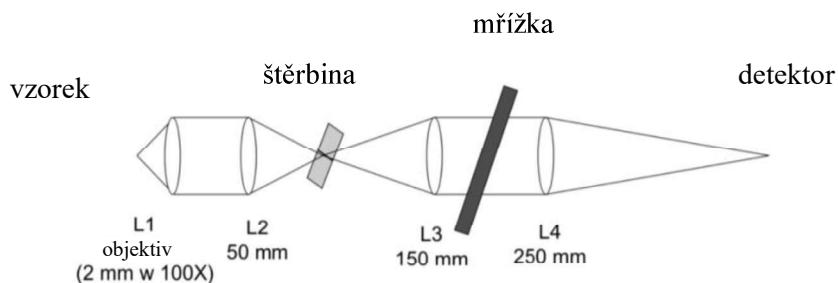
Signál je detekován termoelektricky chlazeným (-70 °C) Renishaw Centrus CCD detektorem (Obr. 3.6) se zvýšenou citlivostí 1024x256 pixelů pro detekci rozptýleného záření v rozsahu 200 nm až 1064 nm s rychlosťí vyčítání spekter až 1800spekter/1 sekundu a velmi nízkou hladinou šumu [17].



Obrázek 3.6: CCD detektor

Vzorek lze pozorovat pomocí zabudovaného vědeckého mikroskopu Leica DM 2700M s možností pozorování vzorku v odraženém světle. Mikroskop Leica je osazen motorizovaným stolkem XYZ Renishaw s krokem 100 nm v XY a 16 nm v ose Z pro měření Ramanových map, hloubkových profilů atd. Místo na vzorku, které chceme pozorovat nebo měřit, lze nastavit pomocí joysticku, šroubu na mikroskopu nebo i softwarově. Mikroskop je vybaven dielektrickými i holografickými Notch filtry. Pokud budeme potřebovat pozorovat vliv polarizace budícího a rozptýleného záření na výsledné spektrum, můžeme k filtrem přidat i polarizátory.

Rozptýlené záření je difraktováno jednou ze dvou mřížek (Obr. 3.7) s hustotou 1200/mm a 1800/mm. Difrakční mřížky jsou magnetické upnuty k softwarově ovládanému motorizovanému nosiči s vestavěným úhlovým odměřováním, který umožňuje připojení dvou difrakčních mřížek pro různé vlnové délky používaných laserů. Mřížky lze snadno softwarově automaticky měnit [17].

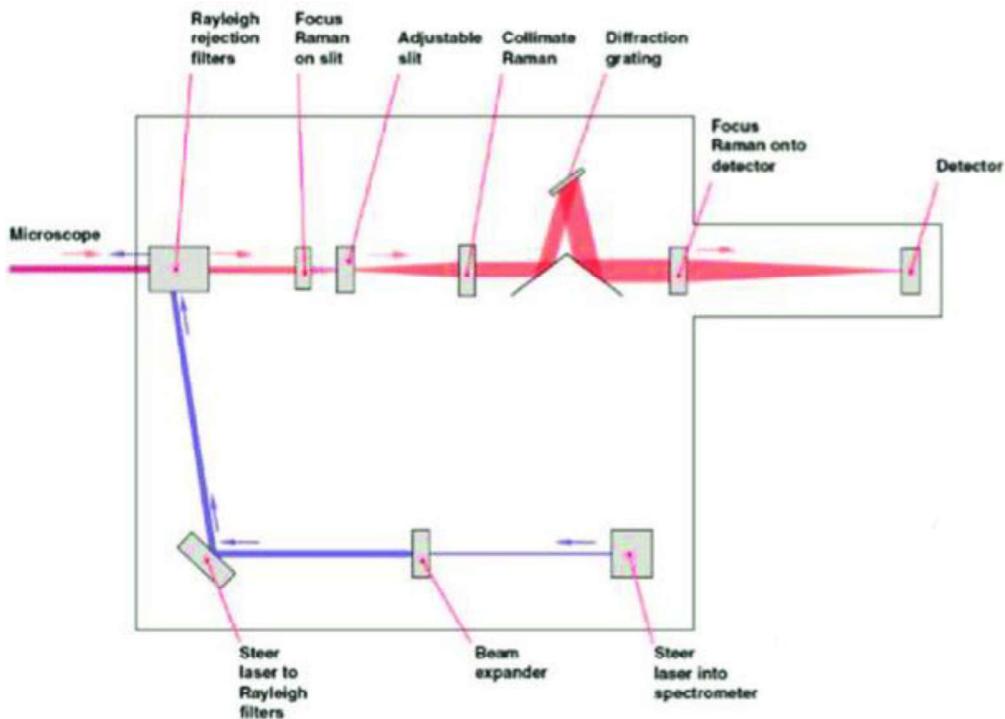


Obrázek 3.7: Dispenzí prvek [podle 17]

Ramanovo spektrum může být snímáno ve dvou různých módech. Během statického skenovaní difrakční mřížka má pevnou definovanou úhlovou polohu. Tak získáváme spektrum s rozsahem ve spektrální oblasti 400 až 1000 cm^{-1} . Při použití rozšířeného skenování se difrakční mřížka během snímání spektra uhlově natáčí po malých krocích a tím dochází k načtení spektra ve větší oblasti 100 cm^{-1} až 10000 cm^{-1} .

Mikrospektrometry firmy Renishaw využívají tzv. pseudo-konfokální systém (schematické znázornění na Obr. 3.8). Výhodou takového systému je, že nemusíme používat kruhovou aperturu, což nám umožní snadné nastavení a vyžaduje méně optických členů.

Přístroj umožňuje provádět automatickou kalibraci přístroje ze softwaru s využitím vestavěných vzorků křemíku, neonové lampy a kalibrovaného zdroje bílého světla pro kalibraci a měření spektrální odezvy přístroje [17].



Obrázek 3.8: Optická dráha paprsku laseru [podle 14]

Potřebujeme dostatečně dlouho před začátkem měření zapnout laser, aby se stačil stabilizovat. Přibližně po 30-40 minutách už můžeme zapínat vlastní spektrometr. Až nakonec zapínáme ovládací software WiRETM. Je to kompletní softwarové prostředí pro ovládání mikroskopu, získání Ramanových spekter a další manipulace s nimi. Po zapnutí přístroj sám kontroluje nastavení některých vnitřních motorizovaných částí spektrometru [17].

Měřený vzorek pak vložíme na podložku pod mikroskop a najdeme na něm vhodné místo pro naše měření Ramanova spektra. Musíme být opatrní při manipulacích s největším 100x objektivem, aby se nedotknul vzorku a tím se nepoškodil.

Přístroj je vybaven teplotní komorou Linkam, kterou lze využít pro studium materiálu v rozmezí teplot -196 °C až 420 °C. Má kontrolér pro nastavení teploty a rychlost ohřevu vzorku je 50 °C za minutu [17].

3.3.2 Softwarové ovládání

Renishaw WiRE 5.1 Software-kompletní softwarový balík pro ovládání přístroje, získávání Ramanových spekter, analýzu a mapování vzorků.

Software WiRE plně podporuje nové hardwarové aplikace a umožňuje rychlé zpracování a manipulace se spektry až do velikosti map obsahujících 50 milionů spekter.

Softwarové a operační módy:

- Automatické přepínání mezi lasery, ND filtry, Edge filtry a difrakčními mřížkami, mezi osvětlením vzorku laserem a bílým světlem
- Automatická kalibrace vlnových délek
- Automatické optimalizace signálu na CCD kameře

Analýza a techniky zpracování spekter:

- “baseline subtraction“ - úprava základny spekter
- “fitování“ a vyhledávání Ramanovych pásů ve spektrech
- “zaping“ - možnost odstranění nechtěných pasů z Ramanova spektra
- aritmetické operace se spektry
- vytváření Ramanove mapy

Mapování muže byt provedeno v bodě, přímce, na ploše nebo ve 3D. V bodovém režimu pomocí foto do a po opálení vzorku je možné zjišťovat, jestli nebyl přehnán výkon a nedošlo k degradaci vzorku.

Pomocí funkce LiveTrack TM system umožnuje automatický fokus na povrch vzorku s možnosti vytvoření Ramanovy mapy ve 3D s topografií povrchu. Autofokus objektivu je prováděn v reálném čase během měření a tím nedochází k žádnému časovému zdržení. LiveTrack TM umožňuje dynamické a rychlé automatické zaostrování, které během měření Ramanovych map automaticky udržuje fokus na vzorku, který se pohybuje ve směru osy Z rychlosti alespoň 10 mikrometrů za sekundu. Umožňuje vytvářet 3D Ramanovy nebo 3D topografické mapy při osvitu vzorku bílým světlem [17].

Metoda SORS (Spatially offset Raman spectroscopy) umožňuje měření Ramanovych spekter z hlubokých vrstev materiálu, nebo vzorku v obalech. SORS měření jsou umožněna offsetem laserového svazku v objektivu tak, že neprochází středem objektivu, ale je posunut o cca 60 μm , a tím je umožněn sběr signálu z hlubších vrstev. Offset lze nastavit v softwaru WiRE 5.1 přístroje pro různé excitační lasery.

K odstranění nežádoucích částí ve průběhu spektra použijeme pomůcku Zap. S její pomocí můžeme snadně vystrihnout např. pík kosmického záření [17].

4 Vodivé polymery

Polovodičove polymery jsou již schopny funkčně konkurovat anorganickým, nemají ale stejnou stabilitu. Jejich výroba je výrazně levnější, což je predikuje k použití ve výrobě levné elektroniky určené k malému počtu užití [18].

Vodivé polymery mají elektronické vlastnosti polovodičů a současně výhody zpracování a mechanické parametry polymerů. Vlastnosti přenosu elektronů a iontů vodivých polymerů jsou silně závislé na jejích morfologii. Rychlosť dopingu a dedopování taky závisí na jejích morfologii. Všechny tyto transportní vlastnosti jsou důležité pro aplikaci vodivých polymerů v elektronických zařízeních, a proto je žádoucí řídit morfologii polymerů během jejich syntézy [27].

Vodivé polymery samostatně nebo ve směsi s běžnými polymery, byly úspěšně použity v bateriích, senzorech, kondenzátorech, tenkovrstvých tranzistorů, solárních článcích, inhibitorech koroze, LED (light-emitting diode), metalizace, úpravě kovových povrchů atd. Rozsáhlou škálu aplikací vodivých polymerů lze připsat jeho snadné syntéze, sníženým nákladům na zpracování, chemické stabilitě a vodivosti, která může dosahovat 10 až 10^3 S cm⁻¹ [19].

4.1 Polyanilin

Nejdůležitějším zástupcem vodivých polymerů je polyanilin (PANI). Polyanilin patří do skupiny polovodičových polymerů společně s polypyrrolem nebo polyacetylenem. Vzhledem ke snadné přípravě, vhodným fyzikálním vlastnostem a stabilitě polyanilinu je perspektivním materiálem. Tvoří mnoho různých vrstev: tenké filmy, disperzní částice či nanoútvary, což dává mnoho možností potenciálního využití. PANI se ukázal jako jeden z nejslibnějších vodivých polymerů díky své nízké ceně a relativně vysoké stabilitě a vodivosti prostředí. Příprava polyanilinu je známá již dávno, přesto je kontrola všech syntetických parametrů, která může umožnit přípravu vzorku PANI se stabilní nanostrukturovanou morfologií, stále obtížným úkolem [27].

PANI existuje v různých formách: leukoemeraldinová báze (LB, plně redukovaná forma), emeraldinová báze (EB, částečně oxidovaná forma) a báze pernigranilin (PNB, plně oxidovaná forma). Mezi různými oxidačními stavami PANI je emeraldinová sůl (ES) jediná, která vykazuje elektrickou vodivost. Nicméně emeraldinová báze může být převedena na vodivou formu soli emeraldinu protonací/deprotonací kyselinou/bází a naopak [19].

5 Ramanova spektra polyanilinových filmů

Tato kapitola se zabývá přípravou tenkých filmů polyanilinu na křemíkových podložkách za různých polymerizačních podmínek a měřením spekter těch vzorků s použitím různých vlnových délek excitačního laseru. Pro nanesení vybraných vzorků, byla použita metoda „dip-coating“. K měření Ramanových spekter byl využit inVia Qontor Ramanův mikrospektrometr firmy Renishaw, který je k dispozice na fakultě Elektrotechnické, ČVUT v Praze.

5.1 Příprava vzorků

Zkoumání vlivu dopováni bylo realizováno na tenkých vzorcích polyanilinu. V následující podkapitole je popsána metoda nanášení vrstvy pro naše měření a experimentální ukázka přípravy jednoho filmu polyanilinu.

5.1.1 Syntéza tenkých filmů polyanilinu

Polymerizace anilinu byla navržena tak, aby byla co nejjednodušší. Pro naše účely byla vybrána metoda „dip-coating“. Účinné polymerizace anilinu je dosaženo pouze v mírně kyselém prostředí, kde anilin existuje jako aniliniový kation. Reakce může probíhat při použití řady kyselin o různé koncentraci a teplotě. Výsledný filmy PANI, proponované různými kyselinami, se liší morfologií, rozpustností, vodivostí, stabilitou, a dalšími vlastnostmi vzniklého polyanilinu [29].

Syntéza byla založena na smíchání dvou vodných roztoků. V prvním roztoku byl rozpuštěn 1 M anilin hydrochloridu v 10 ml destilované vody v odměrné baňce. Druhý roztok byl připraven rozpuštěním peroxydvojsíranu amonného (0,23 g) taktéž v 10 ml vody. Oba tyto roztoky pak byly smíšeny, a tím došlo ke vzniku polyanilinu. Před vložením do toho roztoku vzorky ze křemíku a skla byly čištěny po dobu 15 minut v ultrazvukové čističce v acetonu a pak v isopropylalkoholu zase 15 minut.

Dále po vložení vzorků do roztoku došlo k jejímu pokrytí tenkou polyanilinovou vrstvou. Reakční směs se začala zmodřovat a po 1 minutě polymerizace přešla v tmavě zelenou barvu. Pak až do konce experimentu zadně vizuální změny nebyly mnou pozorovány. Polymerizace probíhala na vzdachu při pokojové teplotě 30 minut. Dále po skončení reakce vzorky byly opláchnuty v destilované vodě a v acetonu.

Konečné připravené tenké filmy polyanilinu hydrochloridu na křemíkové a skleněné podložkách jsou na Obr. 5.1.



Obrázek 5.1: Připravené polyanilinové filmy na křemíku (vlevo) a skle (vpravo)

5.2 Zpracování naměřených Ramanových spekter

Tato podkapitola se již zabývá samotnými naměřenými daty, jejich vyhodnocením a porovnáním s podobnými experimenty u jiných autorů.

Při zpracování naměřených spekter byla využitá metoda dekonvoluce v softwarovém prostředí OriginPro. Dekonvoluce je metoda rozkladu píků, které se navzájem překrývají. Její cílem je zvýraznit skryté vrcholy tak, aby každý představoval místní maximum. Počet experimentálně pozorovaných Ramanových modů je významně menší, několik slabých intenzivních píků se obvykle překrývá se sousedními výraznými píky a způsobuje rozšíření píku [20]. Celý postup, který jsem provedl je následující:

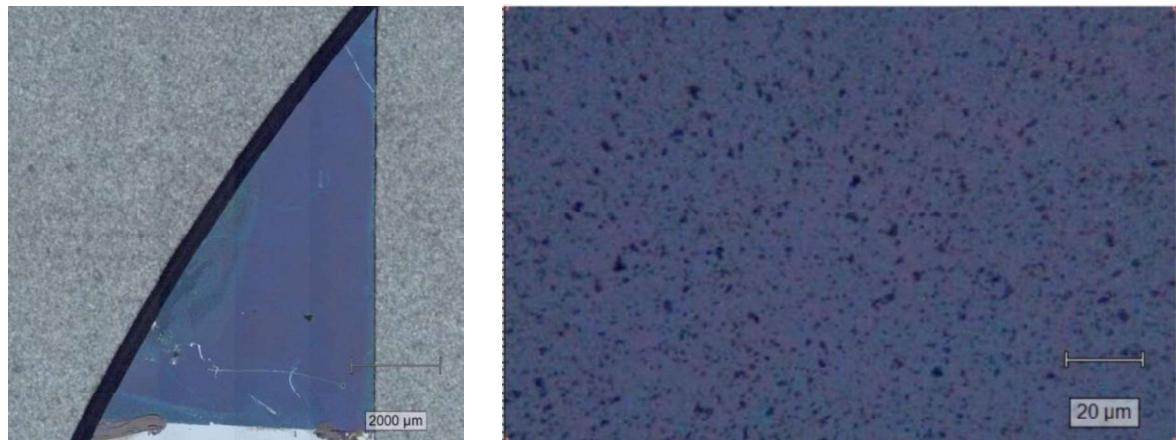
- Nezpracovaná data byla získána s nekonstantní základní úrovní. Proto byla použita korekce základny a tím byl získán normalizovaný Ramanov spektrum vzorku
- Byl vybrán celý rozšířený vrchol (kde byla možnost překryvu počtu vrcholů). Ručně jsem přidal a specifikoval počet a polohu „skrytých“ píku (počet a poloha byly stanoveny z literatury). Dále byla definována špičková funkce (Gaussova) a počet iteraci bylo prováděno, dokud nedojde ke konvergování celkového přizpůsobení

5.2.1 Polyanilinové filmy na křemíkových podložkách

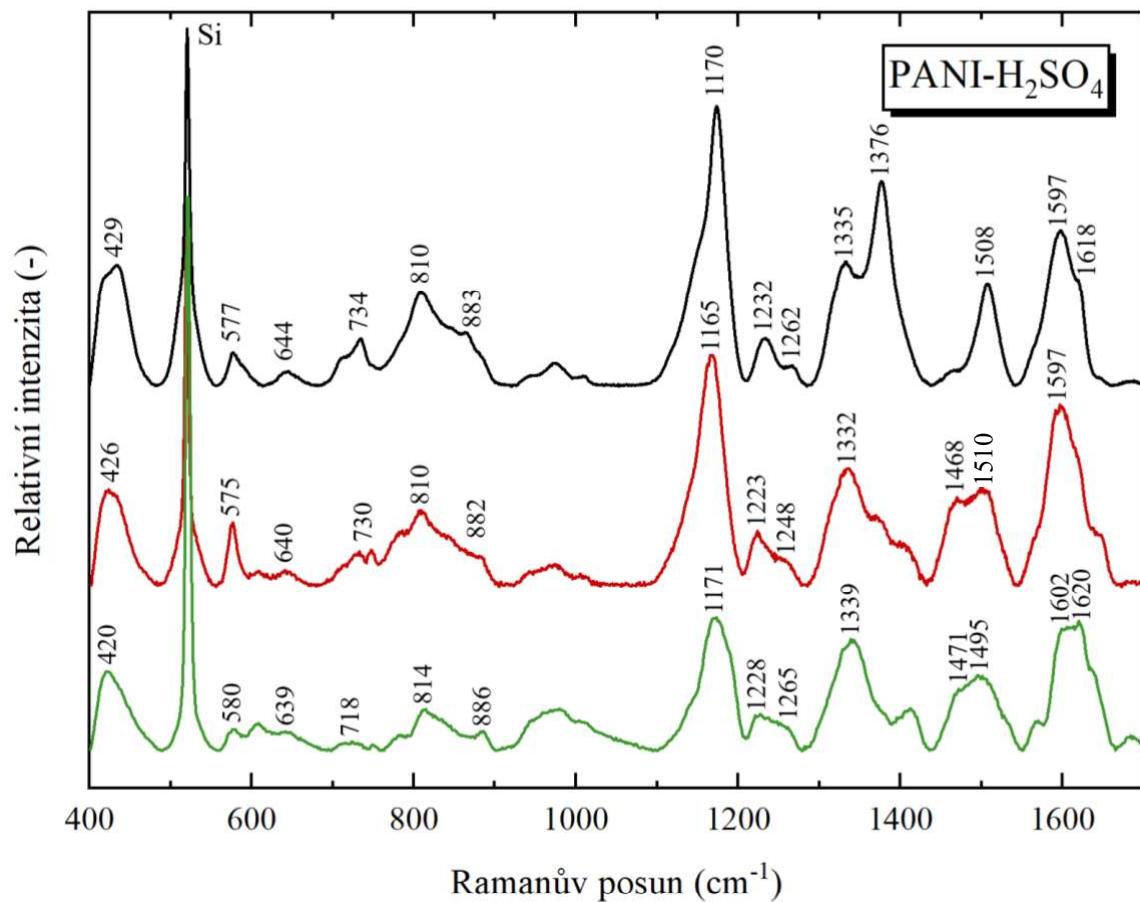
Všechny připravené filmy polyanilinu byly změřeny na Ramanově mikrospektrometru laserem s vlnovými délkami 830 nm (5% výkon, 5 akumulace), 633 nm (10% výkon, 5 akumulace) a 532 nm (5% výkon, 10 akumulace). Charakteristické Ramanovy píky PANI lze pozorovat v rozsahu vlnových délek 400 až 1700 nm [28].

Spektra vzorku polyanilinu připraveného za přítomnosti 0,1 M kyseliny sírové, jehož

fotografie je uvedena na Obr. 5.2, naměřená třemi různými lasery jsou zobrazeny na Obr. 5.3.



Obrázek 5.2: Fotografie filmu polyanilinu připraveného za přítomnosti 0,1 M kyseliny sírové na křemíkové podložce (vlevo - celá plocha, vpravo - měřený bod)



Obrázek 5.3: Ramanovo spektrum filmu PANI-H₂SO₄ připraveného za přítomnosti kyseliny sírové na křemíkové podložce s použitím laseru - 830 nm (černá čara), 633 nm (červená čara), 532 nm (zelená čara)

Ramanovo spektrum filmu polyanilinu připraveného v silné 0,1 M kyselině sírové vykazuje pásy při 429 (426, 420) a 520 cm⁻¹, které odpovídají mimorovinným deformačním vibracím kruhů. Poslední se překrývá silným píkem při 520 cm⁻¹ silikonového substrátu. Pás při 577 (575, 580) cm⁻¹ je přiřazen vibracím fenazinu podobného segmentu. Pás okolo 639-644 cm⁻¹ vzniká z vibrací síranových aniontů. Pás při 734 (730, 718) cm⁻¹ je přiřazen aminovým deformacím v bipolaronové formě emeraldinové soli a pík při 810 cm⁻¹ odpovídá benzenoidním deformačním vibracím. Pás ležící v oblasti 882-886 cm⁻¹ je spojen s C–N–C vibracemi benzenoidních deformačních kmitů v polaronových nebo bipolaronových formách emeraldinové soli.

Pás okolo 1171 cm⁻¹ patří C–H rovinovým deformačním vibracím semichinoidních kruhů. Valenční vibrace C–N vazeb přítomných v různých chinoidních a benzenoidních strukturách odpovídají pásum 1223-1232 cm⁻¹ a 1248-1265 cm⁻¹. Pás ležící v oblasti 1332-1339 cm⁻¹ poskytuje nám informaci o přítomnosti C~N⁺• vibrací delokalizovaných polaronových struktur. Přitom ve spektru vzorku excitovaného laserem 830 nm ve srovnání s jinými spektry kromě píku 1335 nm vzniká vrchol při 1376 cm⁻¹, který má mnohem vyšší intenzitu. Pík při 1468 cm⁻¹ při excitaci laserem 633 nm a pouze malé raménko asi 1471 cm⁻¹ u laseru 532 nm přiradíme C=N valenčním vibracím v chinoidních strukturách. Další pík u vyšších vlnočtů 1508 (1510, 1495) cm⁻¹ je pozorovatelen při použití všech typů laseru a je spojen s N–H deformačními vibracemi příslušných semichinoidních struktur. Při 1597 cm⁻¹ pozorujeme pás C=C valenčních vibrací chinoidních kruhů. Pík okolo 1618 cm⁻¹ je přiřazen C–C valenčním vibracím benzenoidních kruhů.

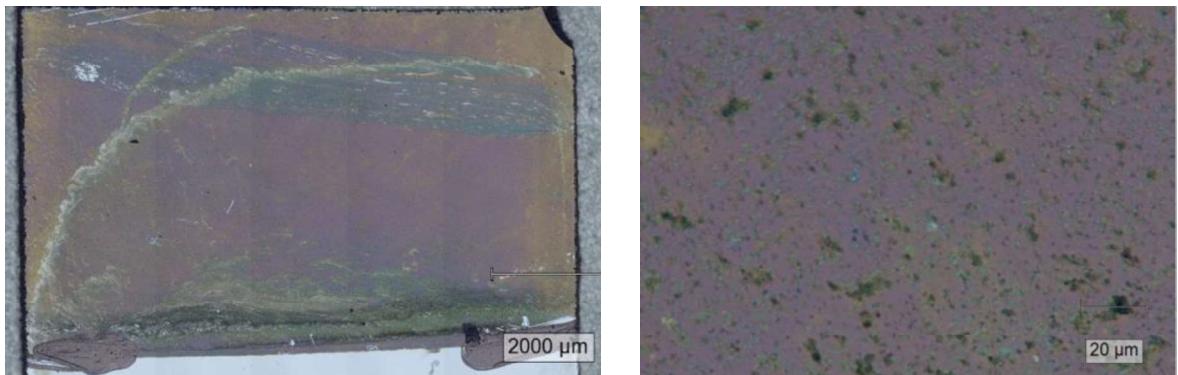
Definované Ramanovy páky filmu PANI-H₂SO₄ ve srovnání s převzetími u jiných autorů pro danou vrstvu a jejích přiřazení jsou shrnutý v Tabulce 5.1.

Vlnočet [cm^{-1}]						Přiřazení jednotlivých píků ve spektru ¹
830 nm	633 nm	532 nm	633 nm (podle [25])	633 nm (podle [22])	532 nm (podle [23])	
429	426	420	417	414		O. p. deformační vibrace kruhů
520	520	520	520	520	520	
577	575	580	575		585	Deformace v bipolaronové formě emeraldinové soli
644	640	639	656	656		
734	730	718	718	718		
810	810	814	810	810	812	B deformační vibrace
883	882	886	874	874	886	C–N–C vibrace B deformačních kmitů v polaronových nebo bipolaronových formách emeraldinové soli
1170	1165	1171	1170	1170	1168	$\delta(\text{C}-\text{H})$ v SQ
1232	1223	1228	1221		1227	$\nu(\text{C}-\text{N})_{\text{Q}}$
1262	1248	1265	1260	1260		$\nu(\text{C}-\text{N})_{\text{B}}$
1335 (1376)	1332	1339	1338	1345	1340	$\nu(\text{C}\sim\text{N}^{+\bullet})$ delokalizovaných polaronových struktur
	1468	1471	1490	1490	1479	$\nu(\text{C}=\text{N})_{\text{Q}}$
1508	1510	1495	1512	1508		N–H deformace v SQ
1597	1597	1602	1585	1584	1582	$\nu(\text{C}=\text{C})_{\text{Q}}$
1618		1620	1623	1624	1623	$\nu(\text{C}-\text{C})_{\text{B}}$

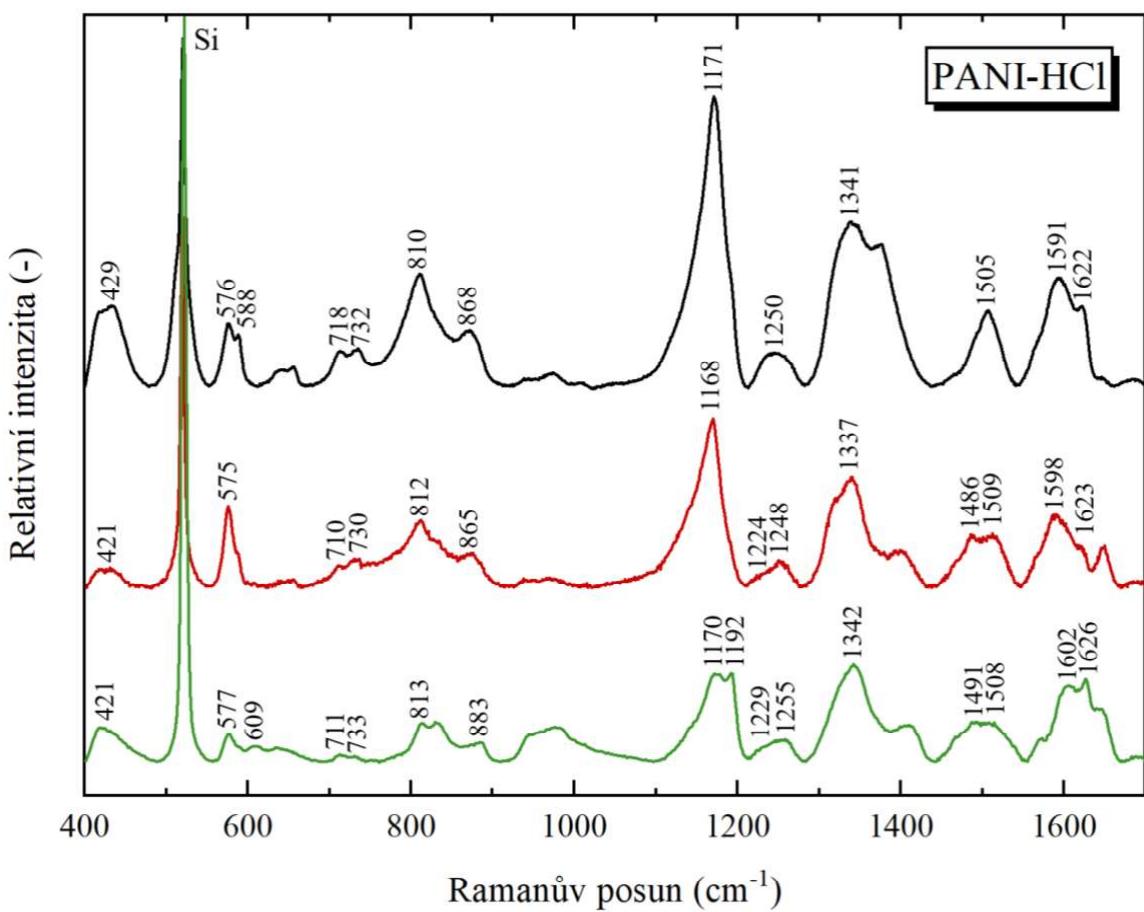
Tabulka 5.1: Ramanův posuv PANI-H₂SO₄ (vlastní měření a převzata z literatury)

¹ Použité zkratky: s - silná; m - střední; w - slabá; sh - rameno; v - valenční vibrace; δ - deformační vibrace; ν – valenční deformace; B - benzenoidní kruh; Q - chinoidní kruh; SQ - semichinoidní kruh; o.p. - mimorovinné vibrace; i.p. - rovinné vibrace.

Spektra vzorku polyanilinu připraveného za přítomnosti 1 M kyseliny chlorovodíkové, jehož fotografie je uvedena na Obr. 5.4, naměřená třemi různými lasery jsou uvedeny na Obr. 5.5.



Obrázek 5.4: Fotografie filmu polyanilinu připraveného za přítomnosti 1 M kyseliny chlorovodíkové na křemíkové podložce (vlevo - celá plocha, vpravo - měřený bod)



Obrázek 5.5: Ramanovo spektrum filmu PANI-HCl připraveného za přítomnosti kyseliny chlorovodíkové na křemíkové podložce s použitím laseru - 830 nm (černá čara), 633 nm (červená čara), 532 nm (zelená čara)

V Ramanově spektru filmu PANI hydrochloridu pozorujeme pásy při 429 cm^{-1} a 421 cm^{-1} odpovídající mimořivinným deformačním vibracím kruhů. Pík 520 cm^{-1} se překrývá s pákem vibrací křemíkové podložky. Pás při 575 - 577 cm^{-1} je přiřazen vibracím fenazinu podobného segmentu, dodatečně vidíme u laserů 830 nm a 532 nm výrazná raménka při 588 cm^{-1} a 609 cm^{-1} . Pás při 711 - 718 cm^{-1} je přiřazen aminovým deformacím v bipolaronové formě emeraldinové soli a pás okolo 810 - 813 cm^{-1} je spojen s benzenoidními deformačními vibracemi. Pík při 868 cm^{-1} odpovídá C–N–C vibracím benzenoidních deformačních kmitů emeraldinové soli. Při ozáření vzorku zelením laserem tento pík se posunul k vyšším vlnočtům na hodnotu 883 cm^{-1} .

Pás 1168 - 1170 cm^{-1} patří C–H rovinným deformačním vibracím semichinoidních kruhů, přičemž při použití laseru 532 nm pozorujeme raménko okolo 1192 cm^{-1} . Valenční vibrace C–N vazeb přítomných v chinoidních a benzenoidních strukturách v původních spektrech nebyly zřetelně pozorovatelný, proto bylo nutné ty páky ručně vytáhnout metodou dekonvoluce. Ve spektru měřením laserem 830 nm pík chinoidních struktur nám chybí, ale u zbývajících laseru jsou to vlnočty 1224 cm^{-1} a 1229 cm^{-1} . V benzenoidních strukturách je to pás 1248 - 1255 cm^{-1} a je přítomen v spektru při použití všech laserů. Pás ležící v oblasti 1332 - 1339 cm^{-1} je spojen s C~N⁺ vibracemi delokalizovaných polaronových struktur. Při měření laserem 830 nm navíc přibylo raménko okolo 1372 cm^{-1} . Pík ve spektru při excitaci laserem 633 nm při vlnočtu 1486 cm^{-1} a pouze malé raménko u laseru 532 nm při 1491 cm^{-1} přiradíme C=N valenčním vibracím v chinoidních jednotkách. Další pás okolo 1505 - 1509 cm^{-1} je pozorovatelen při použití všech laserů a definuje N–H deformační vibrace semichinoidních struktur. Páky při 1591 , 1598 , 1602 cm^{-1} jsou spojeny s C=C valenčními vibracemi chinoidních kruhů. Pás C–C valenčních vibrací benzenoidních kruhů se objevuje okolo 1622 - 1626 cm^{-1} .

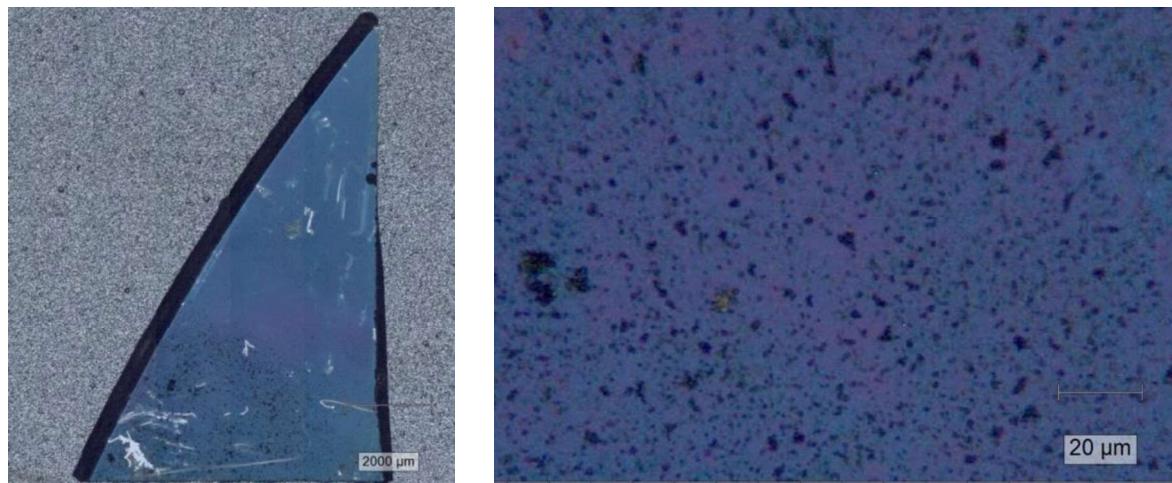
Definované Ramanovy páky filmu PANI-HCl ve srovnání s převzetími u jiných autorů pro danou vrstvu a jejich přiřazení jsou shrnutý v Tabulce 5.2.

Vlnočet [cm^{-1}]						Přiřazení jednotlivých píků ve spektru
830 nm	633 nm	532 nm	Podle [26] 633 nm	Podle [21] 633 nm	Podle [23] 532 nm	
429	421	421	423	417	427	O. p. deformační vibrace kruhů
520	520	520	520	523	502	
576	575	577	578			Deformace v bipolaronové formě emeraldinové soli
588		609			594-612	
718	710	711		751		B deformační vibrace
732	730	733		780		
810	812	813	810	812		C–N–C vibrace B deformačních kmitů v polaronových nebo bipolaronových formách emeraldinové soli
868	865	883		834	833	$\delta(\text{C}-\text{H})$ v SQ
1171	1168	1170 (1192 sh)	1171	1182	1169	
	1224	1229		1221	1227	$\nu(\text{C}-\text{N})_{\text{Q}}$
1250	1248	1255	1260	1257	1260	$\nu(\text{C}-\text{N})_{\text{B}}$
1341 (1372 sh)	1337	1342	1337	1335	1340-1358	$\nu(\text{C}\sim\text{N}^{+\bullet})$ delokalizovaných polaronových struktur
	1486	1491	1480	1480	1486	$\nu(\text{C}=\text{N})_{\text{Q}}$
1505	1509	1508	1506	1504	1520	N–H deformace v SQ
1591	1598	1602	1589	1568	1578	$\nu(\text{C}=\text{C})_{\text{Q}}$
1622	1623	1626		1620	1621	$\nu(\text{C}-\text{C})_{\text{B}}$

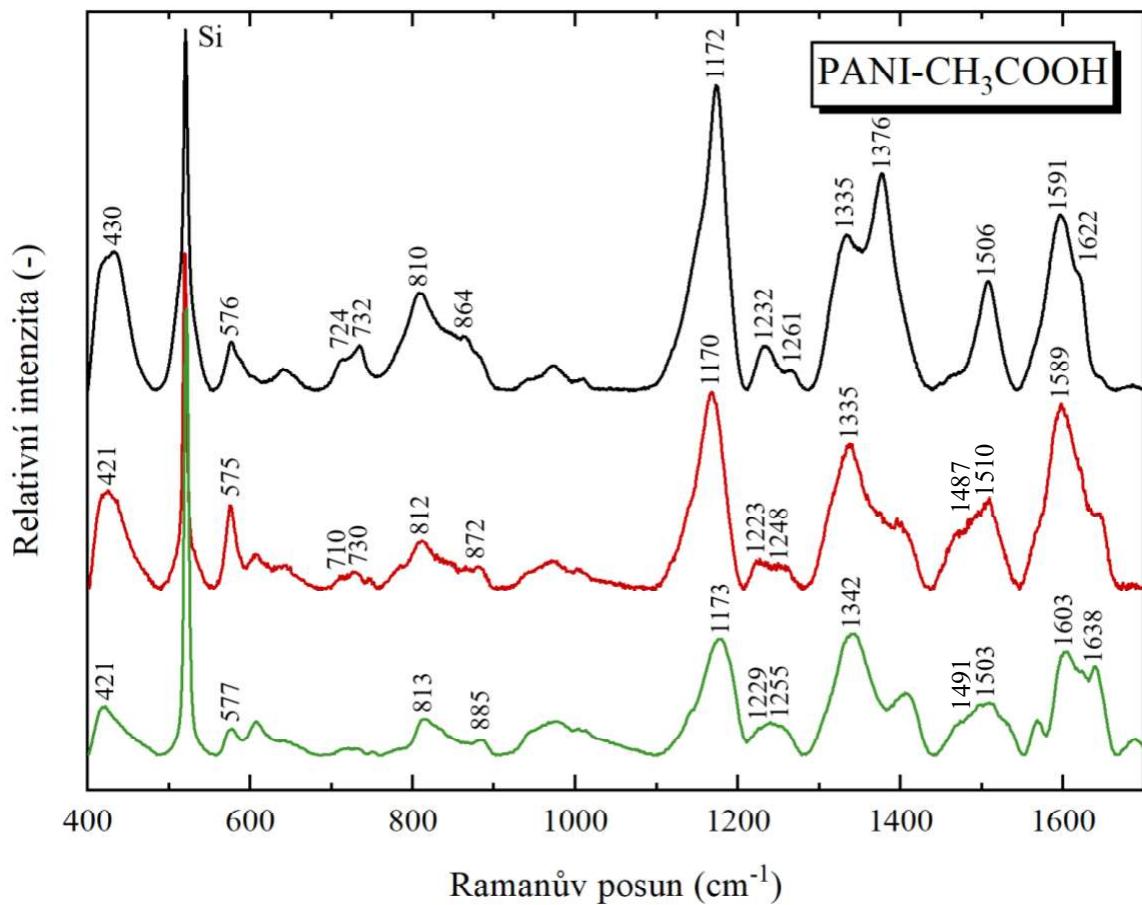
Tabulka 5.2: Ramanův posuv PANI-HCl (vlastní měření a převzata z literatury)

(Vysvětlení zkratek viz Tabulka 5.1.)

Spektra vzorku polyanilinu připraveného za přítomnosti 0.5 M kyseliny octové, jehož fotografie je uvedena na Obr. 5.6, naměřená třemi lasery jsou uvedeny na Obr. 5.7.



Obrázek 5.6: Fotografie filmu polyanilinu připraveného za přítomnosti 0.5 M kyseliny octové na křemíkové podložce (vlevo - celá plocha, vpravo - měřený bod)



Obrázek 5.7: Ramanovo spektrum filmu PANI-CH₃COOH připraveného za přítomnosti kyseliny octové na křemíkové podložce s použitím laseru - 830 nm (černá čara), 633 nm (červená čara), 532 nm (zelená čara)

Spektrum polyanilinové vrstvy připravené za přítomnosti slabé kyseliny octove má skoro stejné pozice píků jako u předchozího vzorku připraveného za přítomnosti silné kyseliny sírové. Pík odpovídající mimorovinným deformačním vibracím kruhů ve spektru měřeném laserem 830 nm je 430 cm^{-1} a lasery 633 nm a 532 nm je 421 cm^{-1} . Pás okolo 576 cm^{-1} je spojen s vibracemi fenazinu podobného segmentu. Pík při 812 cm^{-1} odpovídá benzenoidním deformačním vibracím. Pás, který je spojen s C–N–C vibracemi benzenoidních deformačních kmitů v polaronových nebo bipolaronových formách emeraldinové soli, s růstem vlnové délky excitačního laseru se lehce posouvá k vyšším vlnočtům ve spektru.

Pás při 1172 cm^{-1} patří C–H rovinným deformačním vibracím semichinoidních kruhů. Valenční vibrace C–N vazeb přítomných v různých chinoidních a benzenoidních strukturách odpovídají pásum 1223 – 1232 cm^{-1} a 1248 – 1261 cm^{-1} . Tato oblast v původních spektrech neměla zvýrazněné píky, proto byla potřeba použít metodu dekonvoluce pro jejich určení. Pás ležící v oblasti 1335 – 1342 cm^{-1} poskytuje nám informaci o přítomností $\text{C}\sim\text{N}^{+•}$ vibrací delokalizovaných polaronových struktur. Přitom ve spektru vzorku excitovaného laserem 830 nm ve srovnání s jinými spektry kromě píku 1335 cm^{-1} vzniká vrchol při 1376 cm^{-1} , který má mnohem vyšší intenzitu. Pík při 1487 cm^{-1} při excitaci laserem 633 nm a pouze malé raménko asi 1491 cm^{-1} u laseru 532 nm přiradíme C=N valenčním vibracím v chinoidních strukturách. Další pík okolo 1506 cm^{-1} , který je spojen s N–H deformačními vibracemi příslušných semichinoidních struktur, je přítomen ve všech třech spektrech. Pás okolo 1589 – 1603 cm^{-1} odpovídá C=C valenčním vibracím chinoidních kruhů. Pík okolo 1620 cm^{-1} je přirazen C–C valenčním vibracím benzenoidních kruhů.

Definované Ramanovy píky filmu PANI-CH₃COOH ve srovnání s převzetími u jiných autorů pro danou vrstvu a jejích přiřazení jsou shrnuty v Tabulce 5.3.

Vlnočet [cm^{-1}]						Přiřazení jednotlivých píků ve spektru
830 nm	633 nm	532 nm	Podle [24] 785 nm	Podle [29] 633 nm	Podle [25] 633 nm	
430	421	421	439	414	417	O. p. deformační vibrace kruhů
520	520	520	518	520	520	
576	575	577	575	576	575	Deformace v bipolaronové formě emeraldinové soli
724	710		721	656	718	
732	730					
810	812	813	841	810	810	B deformační vibrace
864	872	885		882	874	C–N–C vibrace B deformačních kmitů v polaronových nebo bipolaronových formách emeraldinové soli
1172	1170	1173	1168	1170	1170	$\delta(\text{C}-\text{H})$ v SQ
1232	1223	1229		1221	1221	$\nu(\text{C}-\text{N})_{\text{Q}}$
1261	1248	1255		1260	1260	$\nu(\text{C}-\text{N})_{\text{B}}$
1335 (1376)	1335	1342	1359	1338	1326	$\nu(\text{C}\sim\text{N}^{+\bullet})$ delokalizovaných polaronových struktur
	1487	1491		1490	1490	$\nu(\text{C}=\text{N})_{\text{Q}}$
1506	1510	1503	1505		1512	N–H deformace v SQ
1591	1589	1603	1589	1593	1595	$\nu(\text{C}=\text{C})_{\text{Q}}$
1622	1620	1638		1621	1623	$\nu(\text{C}-\text{C})_{\text{B}}$

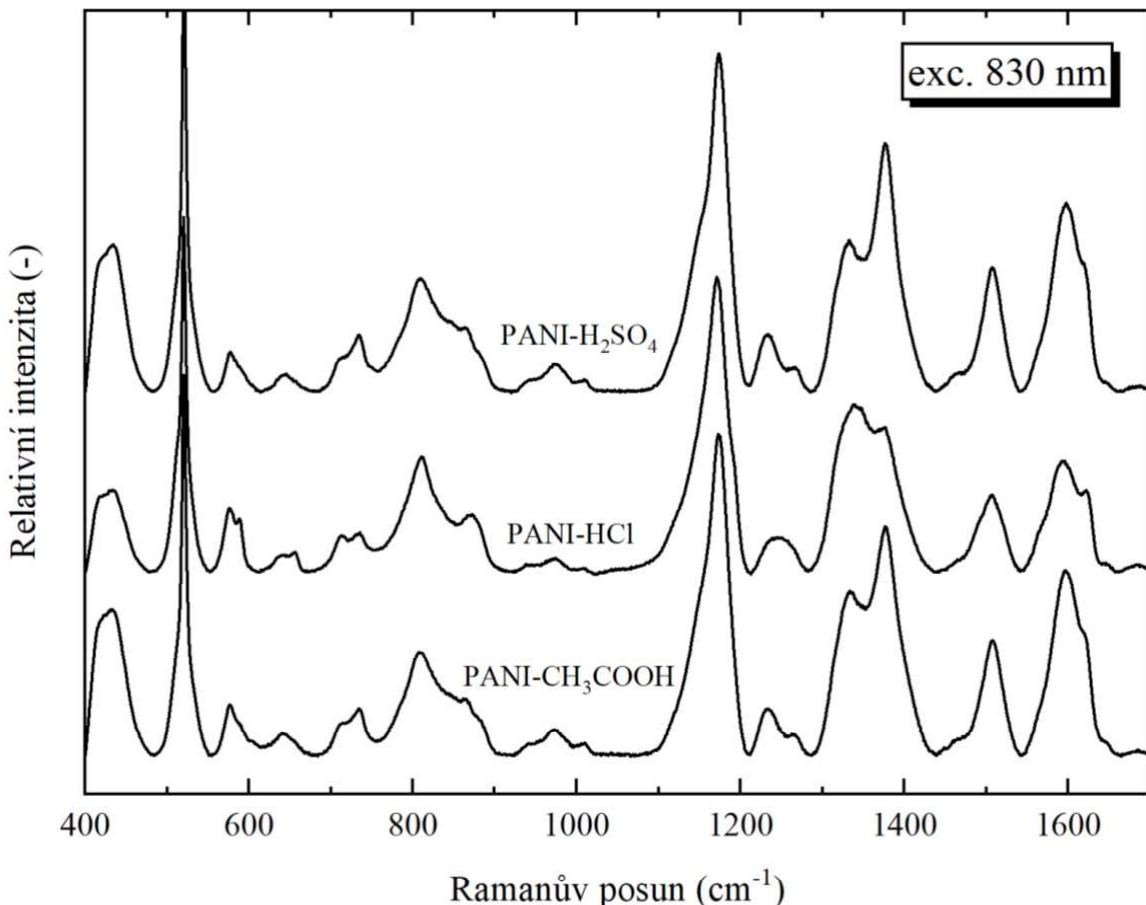
Tabulka 5.3: Ramanův posuv PANI-CH₃COOH (vlastní měření a převzata z literatury)

(Vysvětlení zkratek viz Tabulka 5.1.)

Na Obr. 5.8 jsou vynesena spektra připravených vrstev PANI měřených laserem 830 nm. Spektrum každého vzorků se výrazně liší od spekter s použitím jiných laserů.

U vrstev PANI-H₂SO₄ a PANI-CH₃COOH nepozorujeme tak výrazné změny mezi jednotlivými oblastmi ve spektru, což nelze říct o PANI-HCl.

U polyanilinu hydrochloridu intenzita píku při 575 cm⁻¹ se nezměnila, zatímco se objevil malý pík při 588 cm⁻¹. Použitím laseru 830 nm jsou neustále vylepšeny různé struktury semichinoidních C~N⁺ vibrací delokalizovaných polaronových struktur a v této skupině pásem lze pozorovat významné změny, kde kromě delokalizovaného polaronového píku při 1335 cm⁻¹ vidíme pík 1376 cm⁻¹, který je spojen se semichinoidními jednotkami, ale s nižší polaronovou delokalizací. Maximum píku u PANI-HCl je posunut z 1372 cm⁻¹ na 1341 cm⁻¹. Píky okolo 1505 cm⁻¹ a 1591 cm⁻¹ si prakticky udržují stejnou polohu, ale jejich intenzita je nižší.



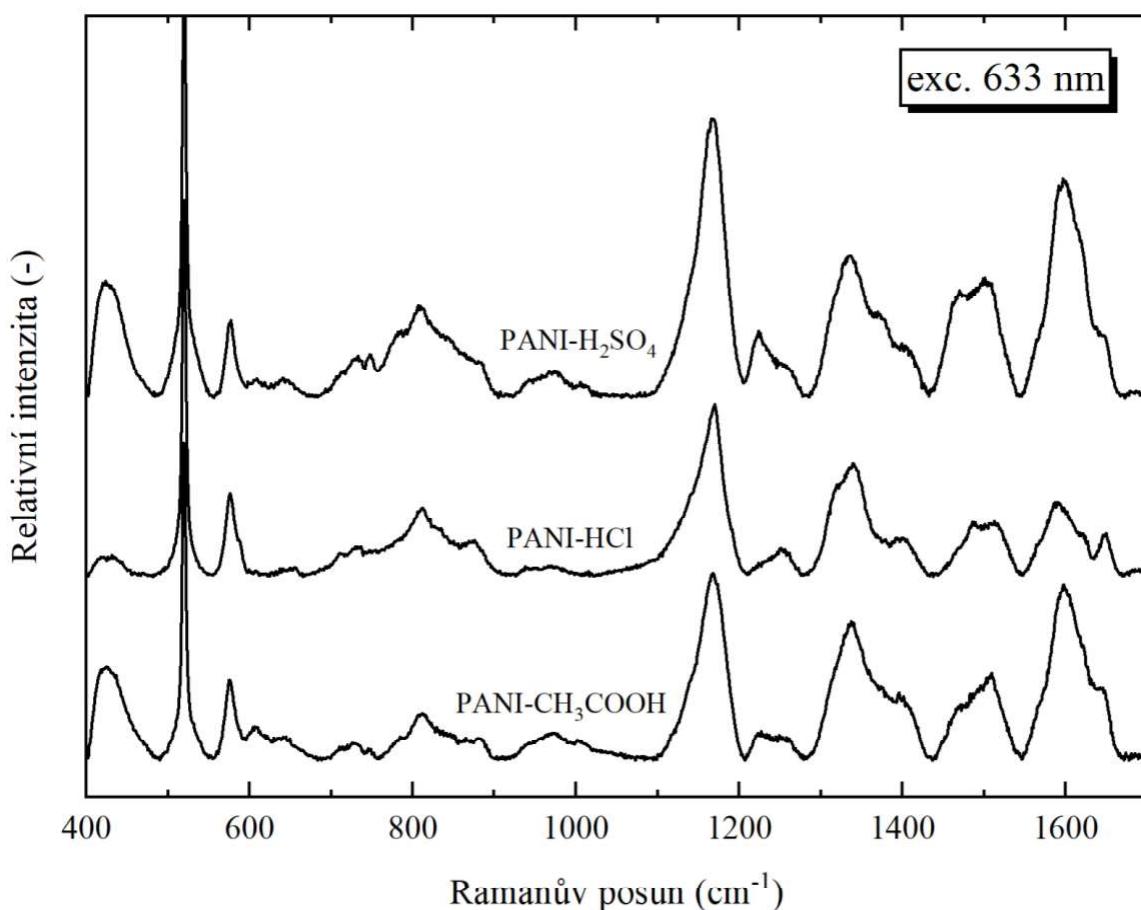
Obrázek 5.8: Ramanovo spektrum filmů PANI-H₂SO₄, PANI-HCl a PANI-CH₃COOH s použitím laseru 830 nm

Vzájemné porovnání spekter zkoumaných vrstev PANI měřených laserem 633 nm je zobrazeno na Obr. 5.9.

Oproti ostatním vzorkům pík okolo 421 cm⁻¹ odpovídající mimorovinným vibracím

kruhů u polyanilinu hydrochloridu má několikrát nižší intenzitu. Pík C–N vazeb v benzenoidních strukturách při 1248 cm^{-1} je vice zesíleny než v chinoidních strukturách při 1224 cm^{-1} . Ale u PANI-H₂SO₄ a PANI-CH₃COOH vidíme opačnou situaci.

Jednotlivé útvary pásů okolo 1509 cm^{-1} a 1598 cm^{-1} se liší poměrem intenzit, což odpovídá různé míře deprotonace u PANI-HCl. Pík odpovídající C=C valenčním vibracím chinoidních kruhů ve spektru vzorku připraveného v kyselině octové je lehce posunut na 1589 cm^{-1} ve srovnání se spektrem vzorku připraveného za přítomnosti kyseliny sírové a chlorovodíkové.

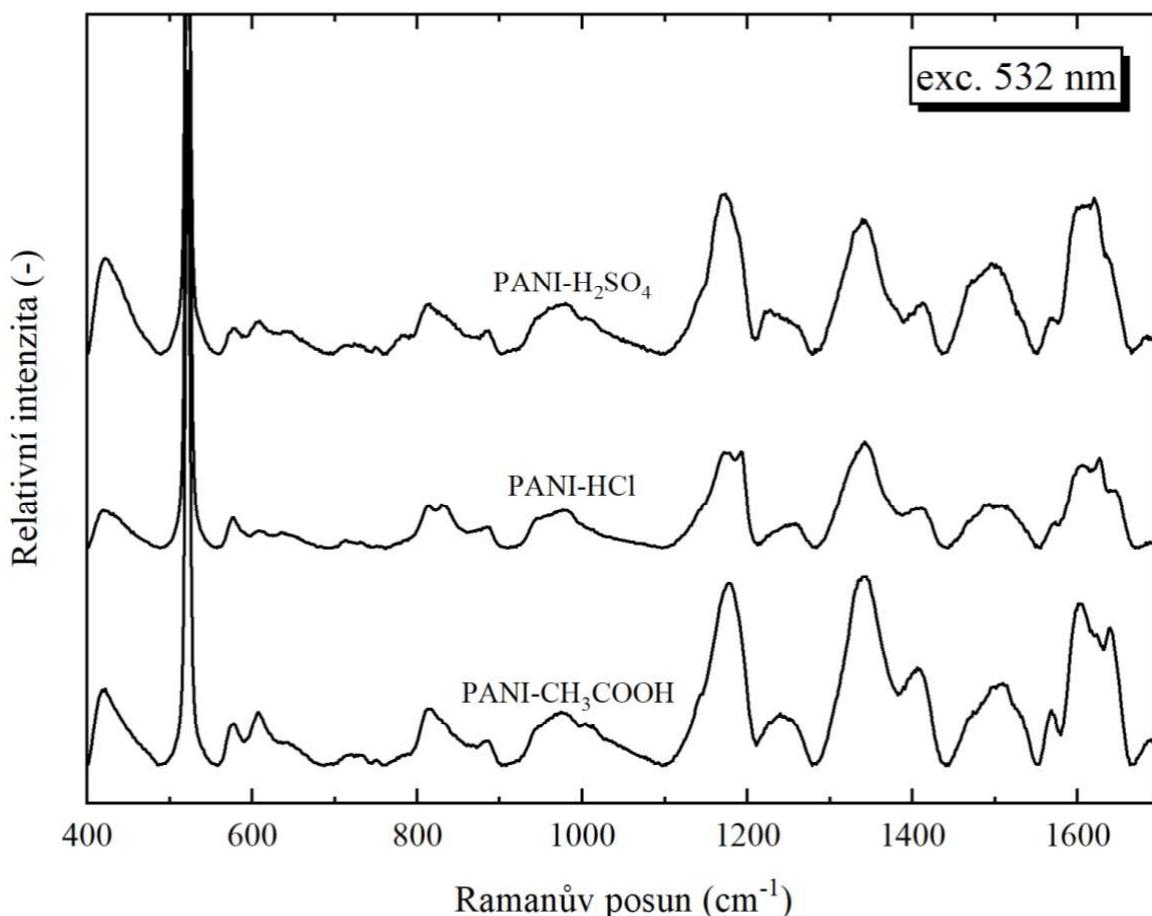


Obrázek 5.9: Ramanovo spektrum filmů PANI-H₂SO₄, PANI-HCl a PANI-CH₃COOH s použitím laseru 633 nm

Na Obr. 5.10 jsou vynesena spektra připravených vrstev polyanilinu měřených laserem 532 nm. Spektra jsou blízké spektrům excitovaným červeným laserem. To naznačuje, že chinoidní jednotky jsou ve filmů skutečně dominantní a nejsou způsobeny pouze rezonančními zesíleními s excitační vlnovou délkou 633 nm.

Samotné filmy mají jiné poměry intenzit nejsilnějších píků než to bylo v měřeních s jinými lasery, protože jsou již vlivem laseru deprotonovány, přičemž se nepodařilo najít vhodné parametry pro jeho nastavení a neovlivněná spektra změřit.

Ve spektru PANI-HCl v oblasti benzenoidních deformačních vibrací přibyl výrazný pík okolo 824 cm^{-1} , který tvoří dublet s píkem 813 cm^{-1} . Pás C–H rovinných deformačních vibrací semichinoidních jednotek u všech vzorků vlivem laseru poklesl a není takový dominantní. U polyanilinu hydrochloridu se objevil pík při 1192 cm^{-1} , který se jeví jako dublet dvou rovnocenných pásů této oblasti.



Obrázek 5.10: Ramanovo spektrum filmů PANI- H_2SO_4 , PANI-HCl a PANI- CH_3COOH
s použitím laseru 532 nm

Na základě těchto výsledků polymerizace polyanilinu při různých koncentracích příměsi kyseliny nepřinesla drastický účinek na chemické vlastnosti PANI, což dokládají charakteristické píky pozorované ve všech vzorcích. To pak naznačuje, že PANI lze syntetizovat pomocí slabšího kyselého dopantu než silného, jako je chlorovodíková kyselina [30]. K určení účinků slabších příměsí kyseliny na morfologické a vodivé vlastnosti vrstev PANI však může být stále zapotřebí dalšího zkoumání.

5.2.2 Vliv laserového záření na vzorek

PANI je poměrně citlivý na ozáření a může se během měření být poškozen laserovým paprskem. V závislosti na energii laserové excitační vlnové délky je zesílena rezonance bud' benzenoidních nebo chinoidních konstitučních jednotek. Aby se zabránilo změnám v molekulární struktuře vzorku a odpovídajícím spektru, má být použita snížená intenzita laseru. Zahřívání vzorku laserem v průběhu měření může totiž způsobovat nejen změny jeho molekulární struktury ale i jeho trvalou degradaci [26].

Vlnová délka 532 nm (příp. 514 nm) není v rezonancí jak s PANI emeraldinovou solí, tak i s bází, ale energie fotonu je vysoká. U tohoto laseru je nutná dlouhá akumulace při nízkém výkonu záření, aby se dosáhlo přijatelné kvality spekter bez poškození vzorku. Spektra se rychle mění se zvyšujícím se výkonem laseru [21].

Excitace při 633 nm je v rezonanci s chinoidními strukturami, takže je snadno detekována částečná deprotonace PANI-ES. Lze očekávat, že vibrační pásy pocházející z chinoidních oxidovaných jednotek budou zesíleny při ozáření týmto laserem. Ramanova spektra je možné bezpečně získat v přijatelné kvalitě bez poškození vzorku při vyšším výkonu, než je tomu u zelené čáry [21].

Při použití laseru 830 nm (příp. 785 nm) budou menší změny spektra původních filmů PANI-ES. Spektrum se výrazně liší od spektra excitovaného laserem s viditelnou vlnovou délkou. Semichinoidní struktury jsou rezonančně zesílene s touto vlnovou délkou, takže ve spektru je zachován hlavní charakter emeraldinové soli [21].

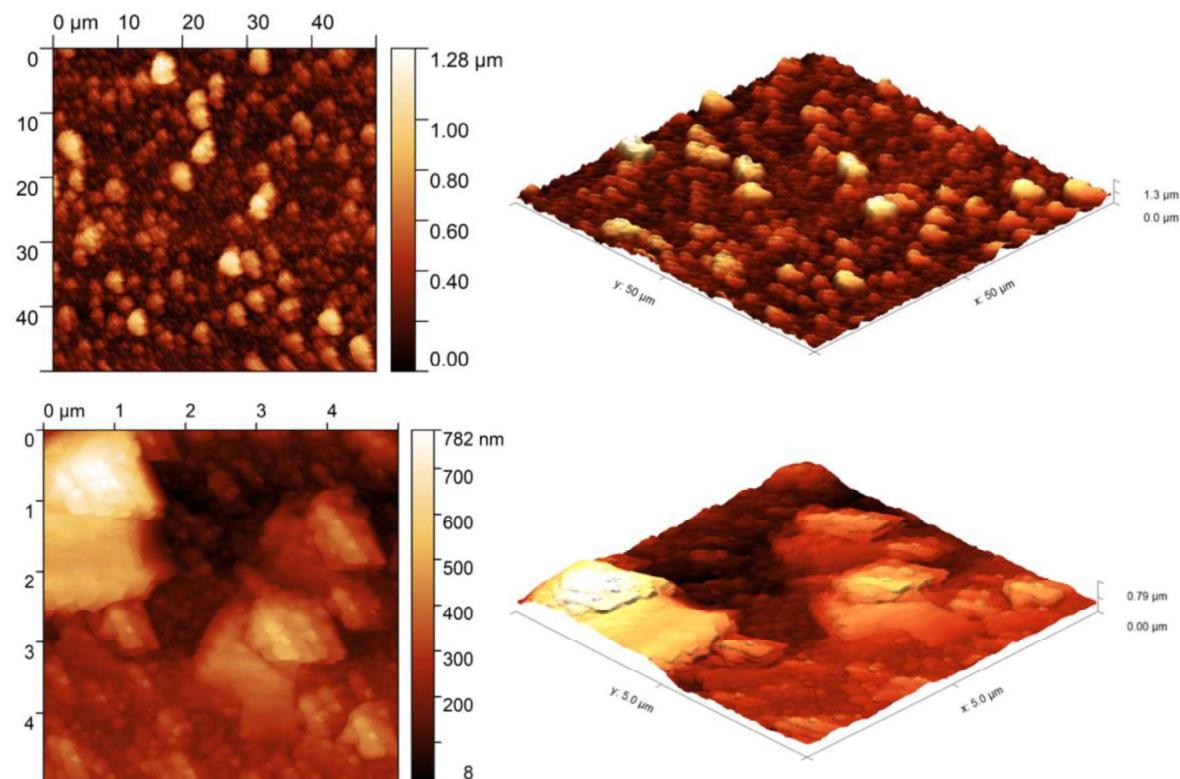
Excitace při 1064 nm je v rezonanci s přechodem π -polaronu PANI-ES a je vysoce absorbováno. Kromě toho je průřez Ramanova rozptylu významně nižší při dílčích vlnových délkách záření, takže je potřeba zvýšit intenzitu. Výsledkem je, že je prakticky nemožné získat Ramanovo spektrum nepoškozeného PANI-ES pomocí této vlnové délky [21]. Maximální výkon laseru použitý při 1064 nm však nestačí ke zničení vzorku, jak se to děje v Ramanově spektru při 633 nm nebo 532 nm [27].

6 AFM a SEM charakterizace vrstev (morfologie vzorků)

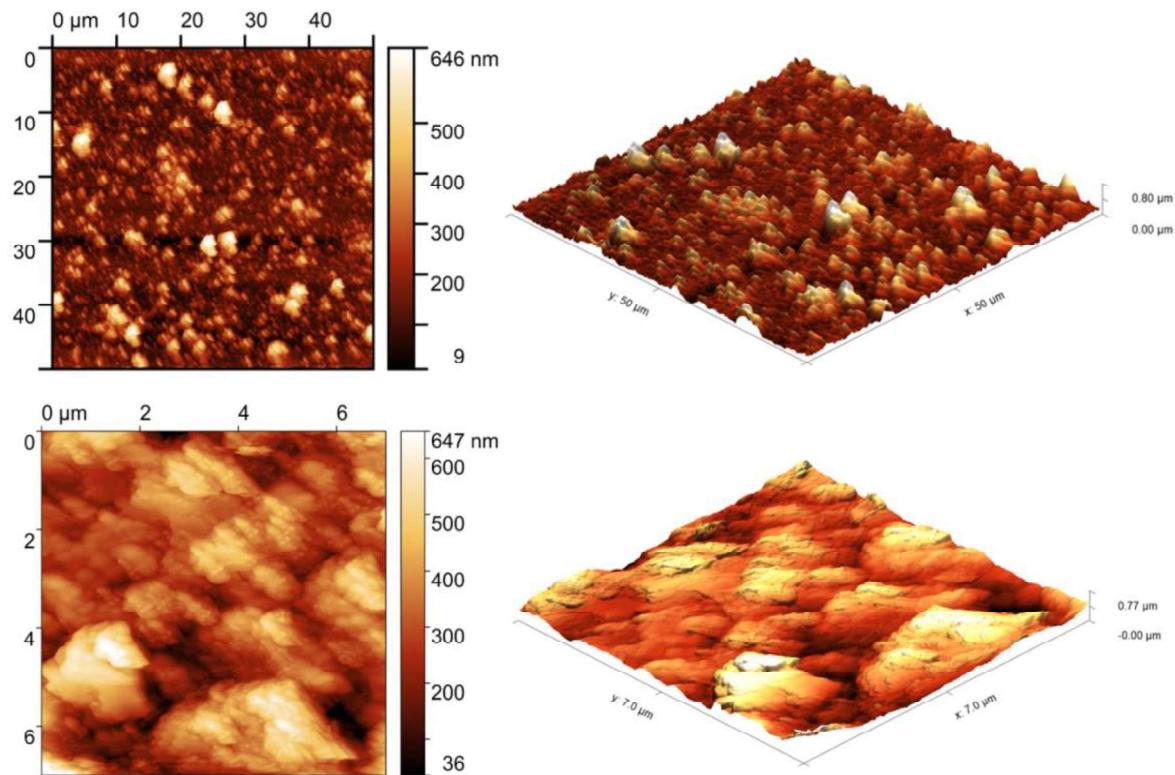
6.1 Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil (Atomic Force Microscope) je další možnou metodou pro pozorování vytvořených povrchových struktur a zobrazení morfologie povrchu. Metoda AFM využívá odpudivých či přitažlivých meziatomárních sil, které působí na atomy hrotu na vzorku. Měření bylo provedeno na mikroskopu Ntegra NT-MDT na katedře Mikroelektroniky FEL, ČVUT.

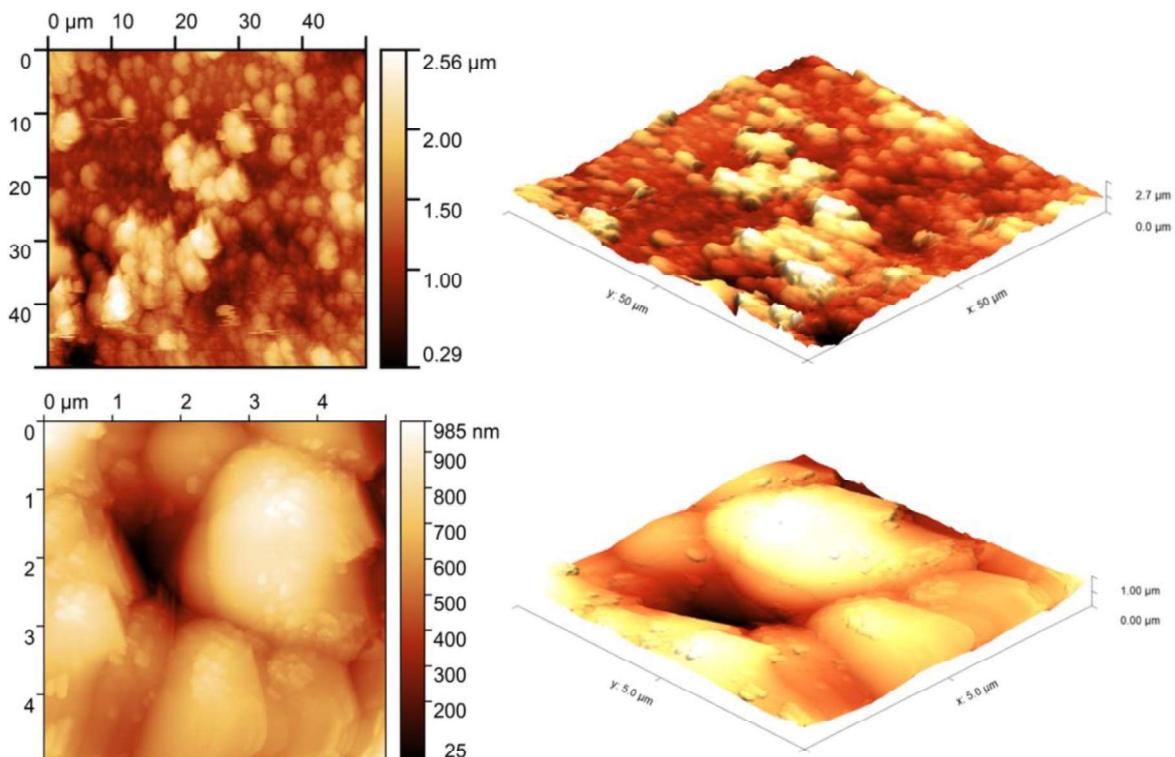
Morfologie připravených tenkých filmů polyanilinu na křemíkových podložkách byla analyzována metodou AFM v semikontaktním módu. AFM skeny vzorků byly provedeny pro oblast $50 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$ (rychlosť skenování $6 \mu\text{m}/\text{s}$, krok 200 nm) a oblast $5 \mu\text{m} \times 5 \mu\text{m}$ (rychlosť skenování $2 \mu\text{m}/\text{s}$, krok 10 nm). Pro měření byly vždy vybrány oblasti bez artefaktů. Na Obr. 6.1 je zobrazena topografie vzorku PANI-H₂SO₄, na Obr. 6.2 vzorku PANI-HCl a na Obr. 6.3 vzorku PANI-CH₃COOH.



Obrázek 6.1: AFM charakterizace povrchu filmu PANI-H₂SO₄



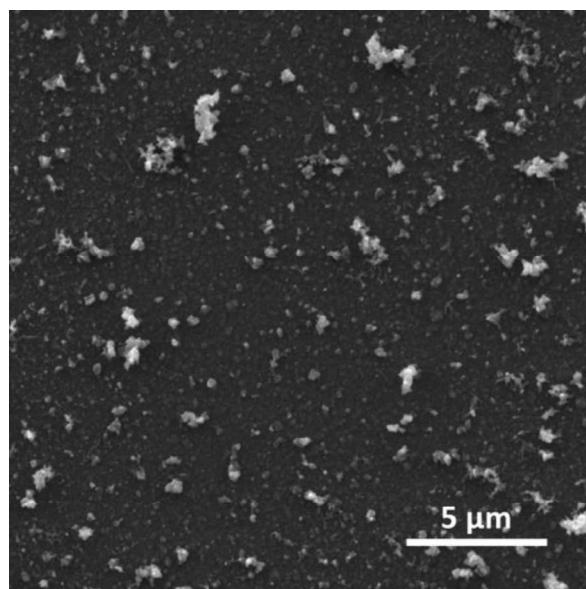
Obrázek 6.2: AFM charakterizace povrchu filmu PANI-HCl



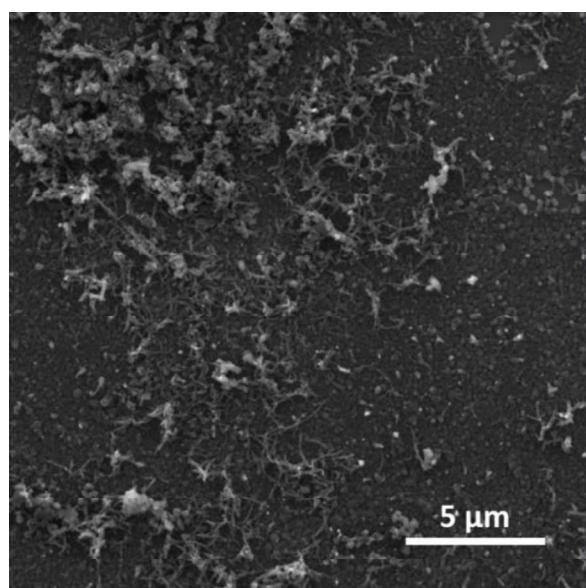
Obrázek 6.3: AFM charakterizace povrchu filmu PANI-CH₃COOH

6.2 Rastrovací elektronová mikroskopie

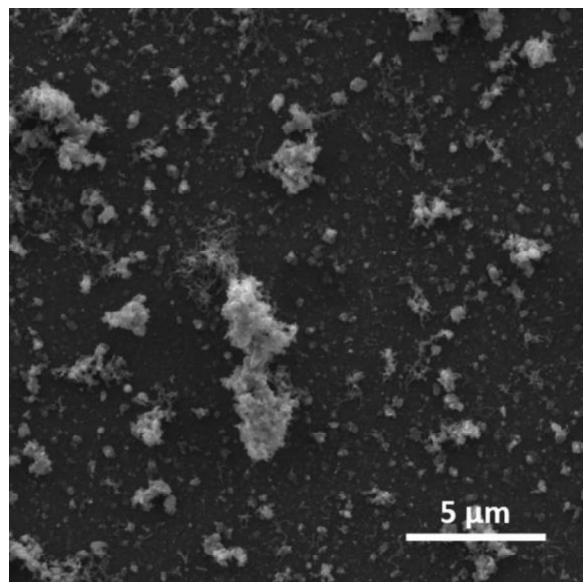
Pro studium morfologie povrchu kromě AFM mikroskopie byla použita i elektronová mikroskopie (SEM). Tato charakterizace byla provedena na přístroji SEM TESCAN FERA3 na pracovišti elektronové mikroskopie Fyzikálního Ústavu AVČR. Na Obr. 6.4 je vidět morfologie vzorku PANI-H₂SO₄, na Obr. 6.5 vzorku PANI-HCl a na Obr. 6.6 vzorku PANI-CH₃COOH. U polyanilinu hydrochloridu na rozdíl od ostatních vrstev pozorujeme výraznou četnost nanotrubkových struktur.



Obrázek 6.4: SEM charakterizace povrchu filmu PANI-H₂SO₄



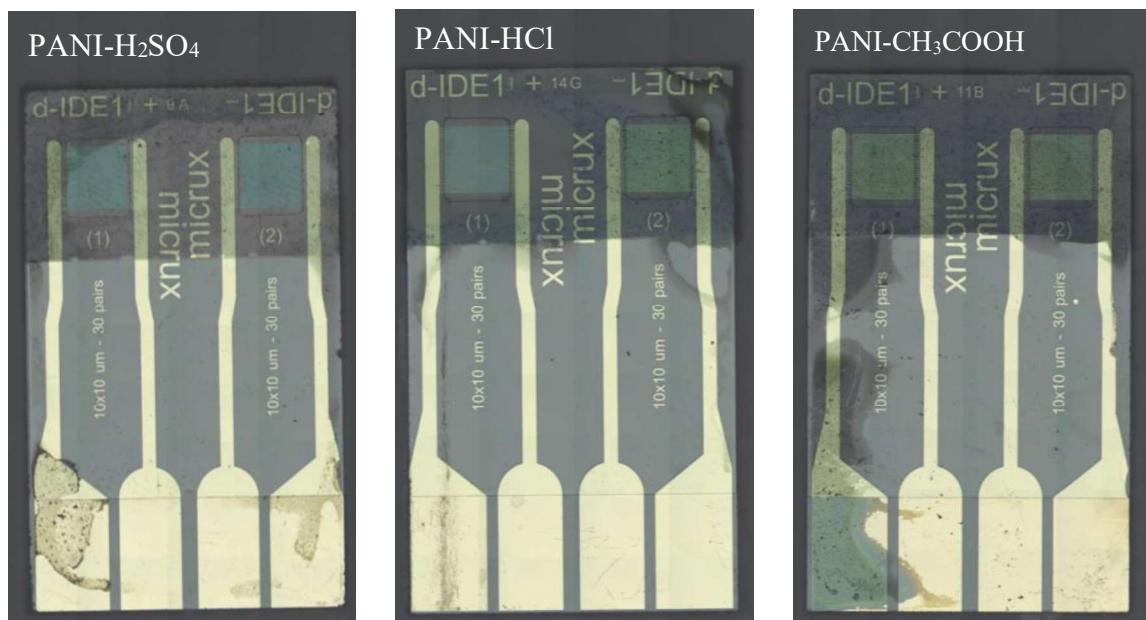
Obrázek 6.5: SEM charakterizace povrchu filmu PANI-HCl



Obrázek 6.6: SEM charakterizace povrchu filmu PANI-CH₃COOH

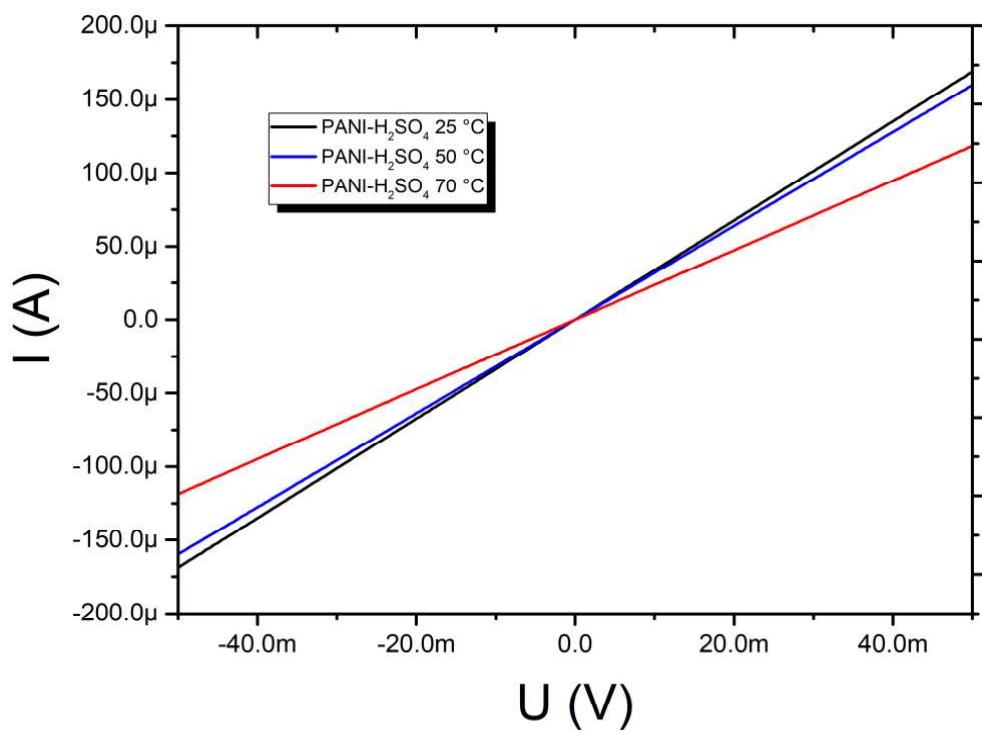
7 Elektrická charakterizace vrstev

Pro sledování vlivu dopování na elektrickou vodivost byly také připraveny vzorky na elektrodách Micrux (interdigitální elektrodová struktura, substrát sklo, materiál elektrod Ti/Pt, 10 µm šířka elektrody, 10 µm šířka mezery, 30 párů, aktivní plocha 1.2 mm x 1.5 mm) s nanesenou vrstvou polyanilinu (Obr. 7.1). U daných vzorků pak byla změřena stejnosměrná voltampérová charakteristika při různé teplotě (pokojová, 50 °C a 70 °C). K měření byla použita hrotová měřici stanice CASCADE MicroTech M150.

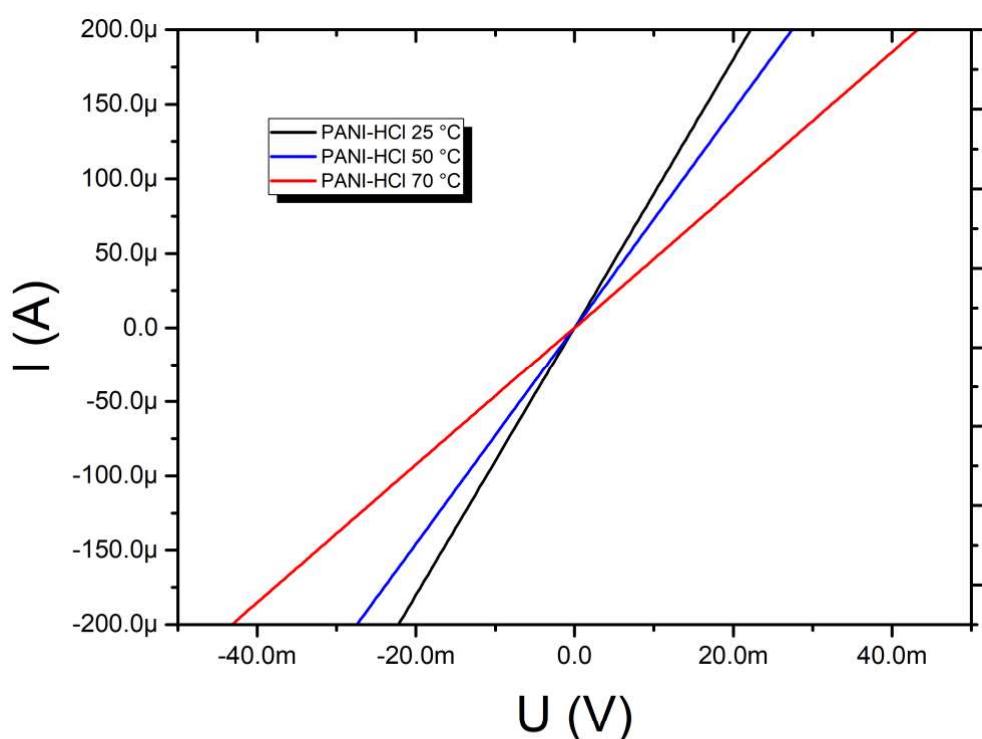


Obrázek 7.1: Fotografie vzorků Micrux s nanesenou vrstvou polyanilinu

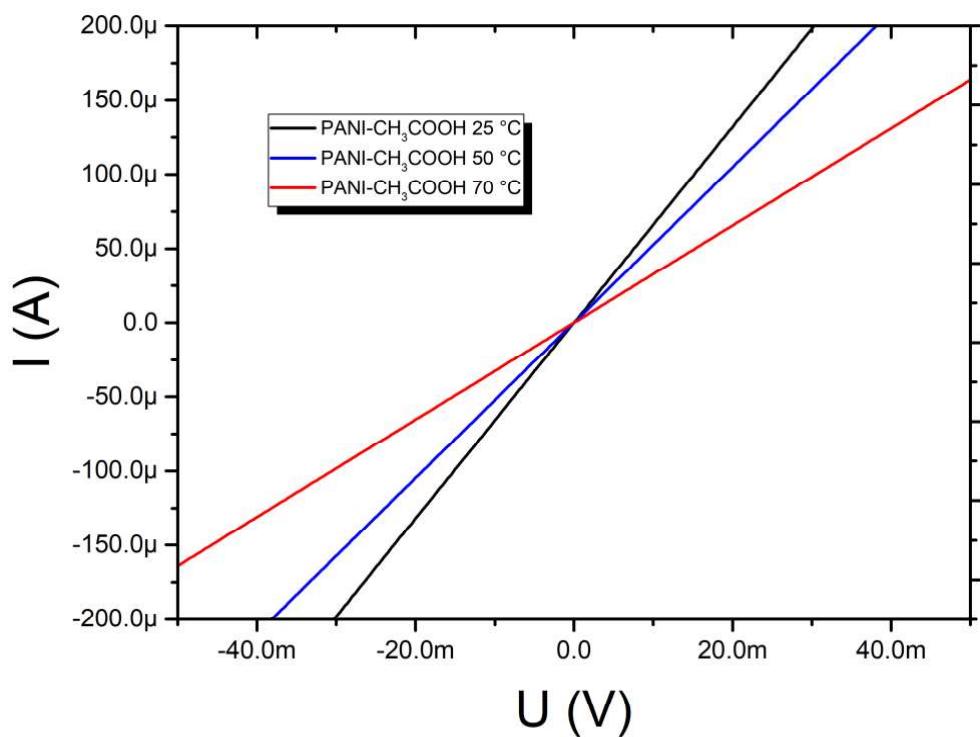
V následujících grafech jsou zobrazeny lineární průběhy V-A charakteristiky připravených vzorků (na Obr. 7.2 s nanesenou vrstvou PANI-H₂SO₄, na Obr. 7.3 - s vrstvou PANI-HCl, na Obr. 7.4 - s vrstvou PANI-CH₃COOH). Dále na Obr. 7.5 je proložena závislost odporu polyanilinových vrstev na teplotě. Pokud porovnáme elektrickou vodivost těch vzorků z hlediska typu použité kyseliny jako dopantu, výsledkem bude, že nejvyšší elektrické vodivosti bylo dosaženo při dopování polyanilinu kyselinou chlorovodíkovou. Naopak nejnižší elektrickou vodivost měl vzorek při dopování kyselinou sírovou.



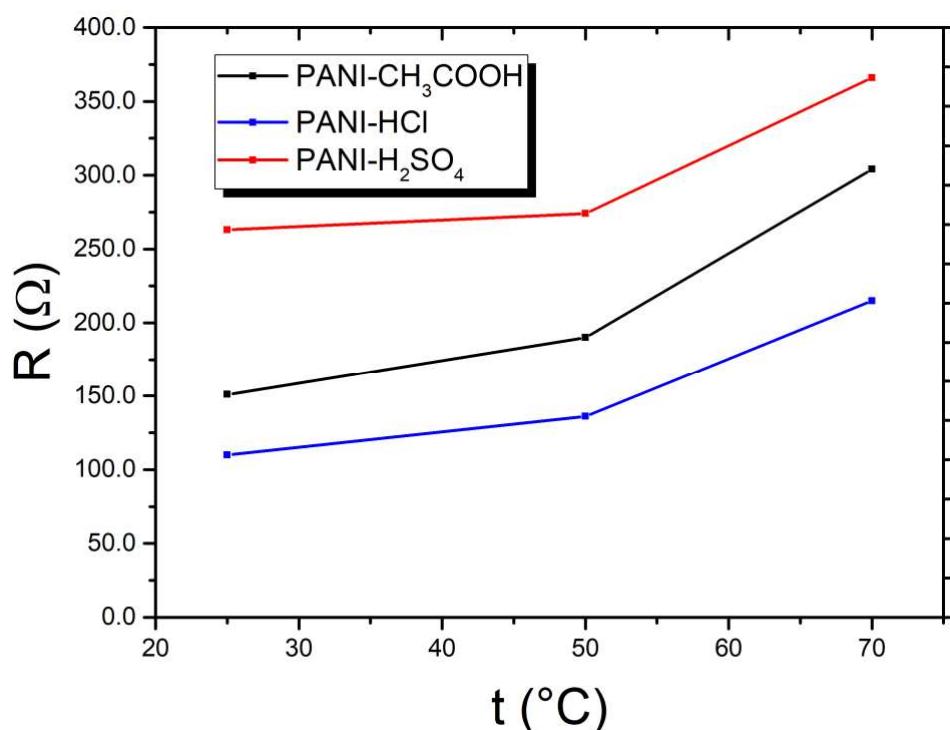
Obrázek 7.2: V-A charakteristika PANI dopovaného sírovou kyselinou



Obrázek 7.3: V-A charakteristika PANI dopovaného chlorovodíkovou kyselinou



Obrázek 7.4: V-A charakteristika PANI dopovaného octovou kyselinou



Obrázek 7.5: Závislost odporu vrstvy na teplotě

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat teoretické základy Ramanovy spektroskopie a její využití pro analýzu tenkých vrstev organických polovodičů.

Teoretická část práce představuje komplexní pohled na problematiku Ramanově spektroskopii pro studování molekulové struktury zkoumaného materiálu. V této části byly nejprve probrány základní principy Ramanova jevu a metody analýzy. Využitím poznatků v daném oboru, dále byla popsána spektrometrická instrumentace (zdroj záření, disperzní prvek a detektor), optická cesta a základní uspořádání Ramanova spektrometru a konkrétně Renishaw InVia Qontor mikrospektrometru.

Po prostudování této problematiky byly syntézovány tenké polyanilinové filmy na křemíkové podložce za různých polymerizačních podmínek (PANI-H₂SO₄, PANI-HCl a PANI-CH₃COOH). Připravené vzorky pak byly analyzovány pomocí Ramanova spektrometru a excitačních laseru o vlnových délkách 830 nm, 633 nm a 532 nm. Získána Ramanova spektra a jejích píky se shodují s výsledky publikovanými jinými autory. Bylo tak dosaženo správného postupu syntézy vrstev polyanilinu a nalezeny vhodné podmínky pro pozorovaní a analýzu těchto vrstev. Jako nejvhodnějším se ukázalo použití laseru o vlnové délce 633 nm a 830 nm, přitom během práce s laserem o vlnové délce 532 nm nebyly zjištěny optimální parametry pro kvalitní zobrazení Ramanova spektra. Dalším cílem bylo provádění charakterizace pomocí AFM a SEM a změření základních elektrických vlastností vrstev při různých teplotách (25 °C - pokojová, 50 °C a 70 °C). Nejlepší elektrickou vodivost při různých teplotách ukázala vrstva polyanilinu připraveného za přítomnosti kyseliny chlorovodíkové.

Uvedené výsledky lze použít k charakterizaci stability různých polyanilinových vrstev v nejrůznějších aplikacích.

Literatura

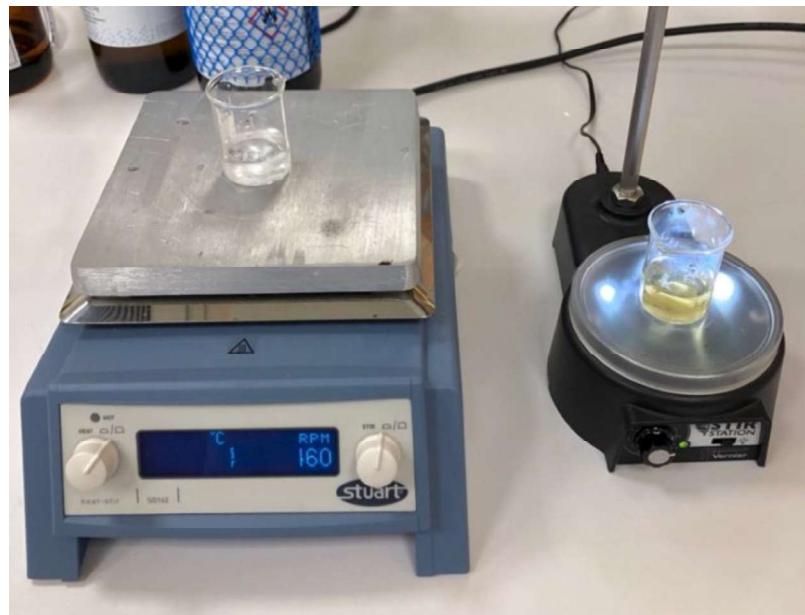
- [1] KLOUDA, Pavel. *Moderní analytické metody*. 3., upravené vydání. Ostrava: Pavel Klouda - nakladatelství Pavko, 2016. ISBN 9788086369228.
- [2] LONG, Derek A. *Raman effect: Unified processing of the theory of Raman scattering by molecules*, John Wiley & Sons, Ltd, 2002, ISBN 9780470845769.
- [3] SCHRADER, B. *Infrared and Raman spectroscopy - methods and applications*. VCH, Weinheim, 1995, DM 298, ISBN 3-527-26446-9.
- [4] WACHSMANN-HOGIU Sebastian, Tyler WEEKS, Thomas HUSER. *Chemical analysis in vivo and in vitro by Raman spectroscopy - from single cells to humans*, Current Opinion in Biotechnology, Volume 20, Issue 1, 2009, pp. 63-73, ISSN 0958-1669.
- [5] ATKINS Peter a Julio DE PAULA. *Atkin's Physical Chemistry*, Czech Edition. Praha: Vysoka škola chemicko-technologická v Praze, 2013, ISBN 978-80-7080-830-6.
- [6] OGANOV A. R., R. J. HEMLEY, R. M. HAZEN a A. P. JONES. *Structure, Bonding, and Mineralogy of Carbon at Extreme Conditions*. Reviews, Mineralogy and Geochemistry, vol. 75, issue 1, 2013.
- [7] MALARD L. M. et al. *Raman spectroscopy in graphene*. Physics Reports, vol. 473, 2009.
- [8] ANTHONY T. R. et al. *Thermal conductivity of isotopically enriched ^{12}C diamond*, Physical Review B. 42 (2): 1104–1111, 1990.
- [9] PRAWER S. et al. *The Raman spectrum of nanocrystalline diamond*, Chemical Physics Letters 332, 2000.
- [10] JABLONSKI, Aleksander. *Anti-flow fluorescence efficiency*, Nature, vol. 131, pp. 839-840, 1993.
- [11] KOENEN J., HOLLRICHER O., WEISHAUPP K. *Confocal Raman microscope, Confocal Raman microscope CRM200, Operating manual*, Wissenschaftliche Instrumente und technologie GmbH, Ulm, Germany, 1998.
- [12] SINGH, Amit a Gopinathan, KARUMATHIL. *Confocal microscopy: Powerful technique for biological research*. Curr Sci. 74, 1997.
- [13] NWANESHIUDU A. et al. (2012). *Introduction to confocal microscopy*. The Journal of investigative dermatology. 132. e3., 2012.
- [14] *Confocal Scanning Laser Microscope OLS3000/3100, User's manual*, Ver. 5.0, 2007.
- [15] DELHAYE M. et al. *Instrumentation in Raman microscopy: Developments and applications*, Academic Press London, 1996.

- [16] HOLLRICHER O. *Raman instrumentation for confocal Raman microscopy*, Confocal Raman microscopy, pp. 43-60, Springer series in optical sciences, Springer, Berlin, 2010.
- [17] Materiály firmy Renishaw.
- [18] MACDIARMID A. G. *Synthetic metals: A Novel Role for Organic Polymers*, Synthetic Metals, vol. 125, 2001.
- [19] GOMES E. C., M. A. S. OLIVEIRA. *Chemical Polymerization of Aniline in Hydrochloric Acid (HCl) and Formic Acid (HCOOH) Media. Differences Between the Two Synthesized Polyanilines*, American Journal of Polymer Science, 2012.
- [20] *Electronic Supplementary Material (ESI) for Dalton transactions*. The Royal Society of Chemistry, 2020.
- [21] MORÁVKOVÁ Z., P. BOBER. *Writing in a Polyaniline Film with Laser Beam and Stability of the Record: A Raman Spectroscopy Study*, Praha, 2018.
- [22] ROZLÍVKOVÁ Z. *Ramanova spektroskopie vodivých polymerů*, Praha, 2009.
- [23] NEKRASOV A. A. et al. *Raman spectroelectrochemical study of electrodeposited polyaniline doped with polymeric sulfonic acids of different structures*, 2016.
- [24] GIZDAVIC-NIKOLAIDIS M. R. et al. *Self-assembly of nanostructures obtained in a microwave-assisted oxidative polymerization of aniline*, eXPRESS Polymer Letters vol. 8, no.10, 2014, pp. 745-755.
- [25] TRCHOVÁ M. et. al. *Raman spectroscopy of polyaniline and oligoaniline thin films*, Praha, 2013.
- [26] STEJSKAL J. et al. *Conducting Polymers: Polyaniline*, in Encyclopedia of Polymer Science and Technology, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2015.
- [27] Gustavo M. do NASCIMENTO, Márcia L. A. TEMPERINI. *Studies on the resonance Raman spectra of polyaniline obtained with near-IR excitation*. JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY, 2007.
- [28] ŠEDĚNKOVÁ I. et. al. *Thermal degradation of polyaniline films prepared in solutions of strong and weak acids and in water – FTIR and Raman spectroscopic studies*, in Polymer Degradation and Stability, vol. 93, no. 12, 2008, pp. 2147-2157.
- [29] STEJSKAL J. *Polyaniline. Preparation of conductive polymer*. Pure and Applied Chemistry, 2002.
- [30] PASELA, Bianca Rae et al. *Synthesis and Characterization of Acetic Acid-Doped Polyaniline and Polyaniline-Chitosan Composite*. Biomimetics, Switzerland, vol. 4,1 15, 2019.

[31] *Encyclopædia Britannica*, Inc. Dostupné z:

<https://www.britannica.com/technology/microscope/Confocal-microscopes>.

Příloha A. Syntéza tenkých filmů polyanilinu



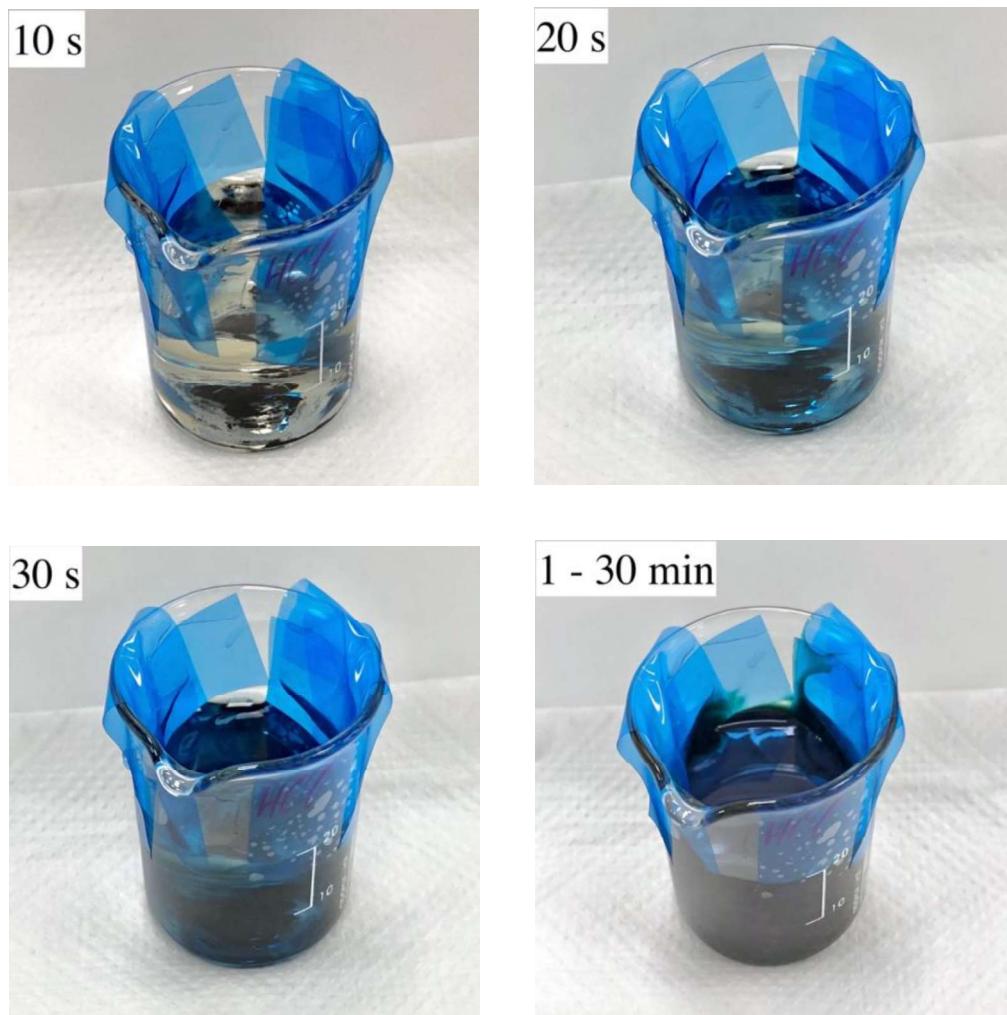
Obrázek A.1: Míchání roztoků



Obrázek A.2: Čištění vzorků v čističce

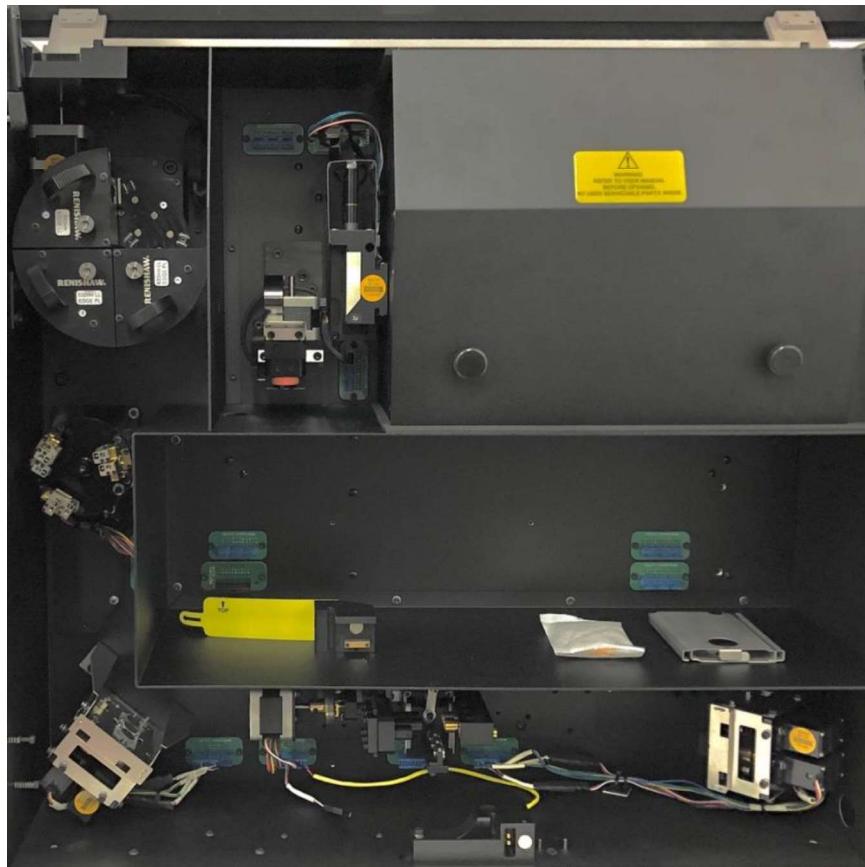


Obrázek A.3: Připravené vodní roztoky a vzorky v prázdné baňce

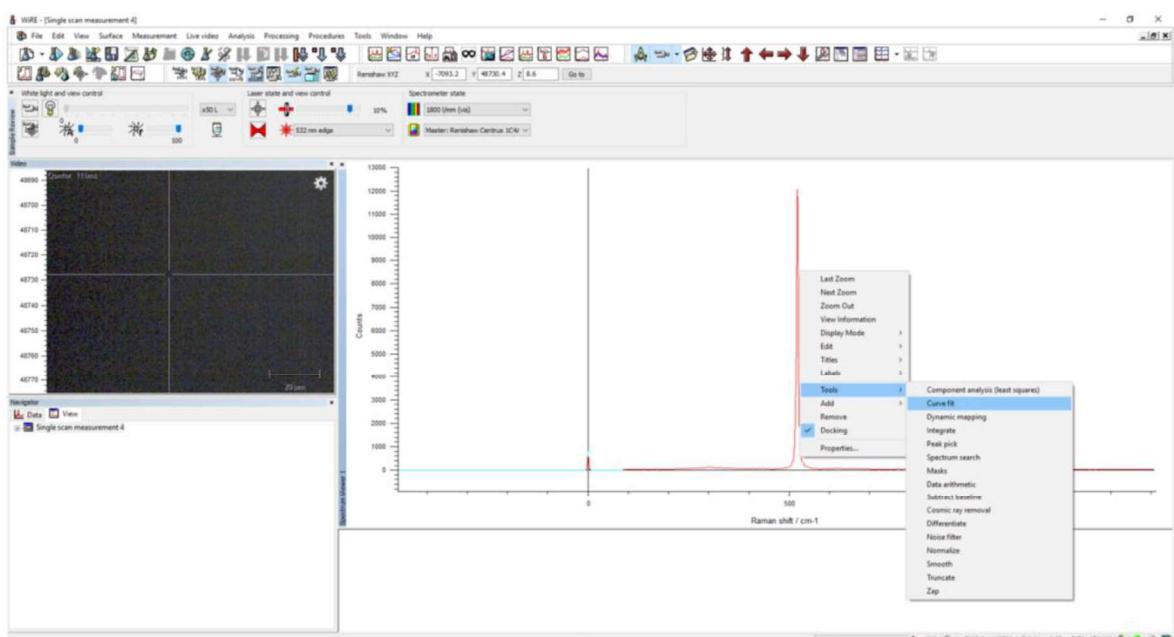


Obrázek A.4: Barevní změny během polymerizace PANI-HCl

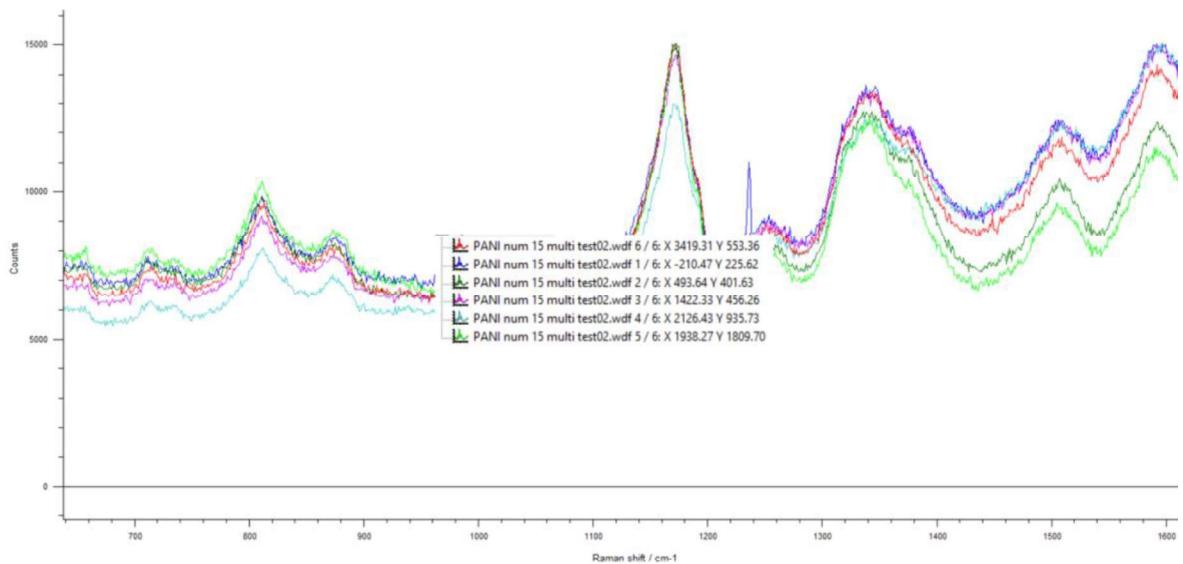
Příloha B. Vnitřní vybavení Ramanova mikrospektrometru a použitého software pro práci s tímto přístrojem



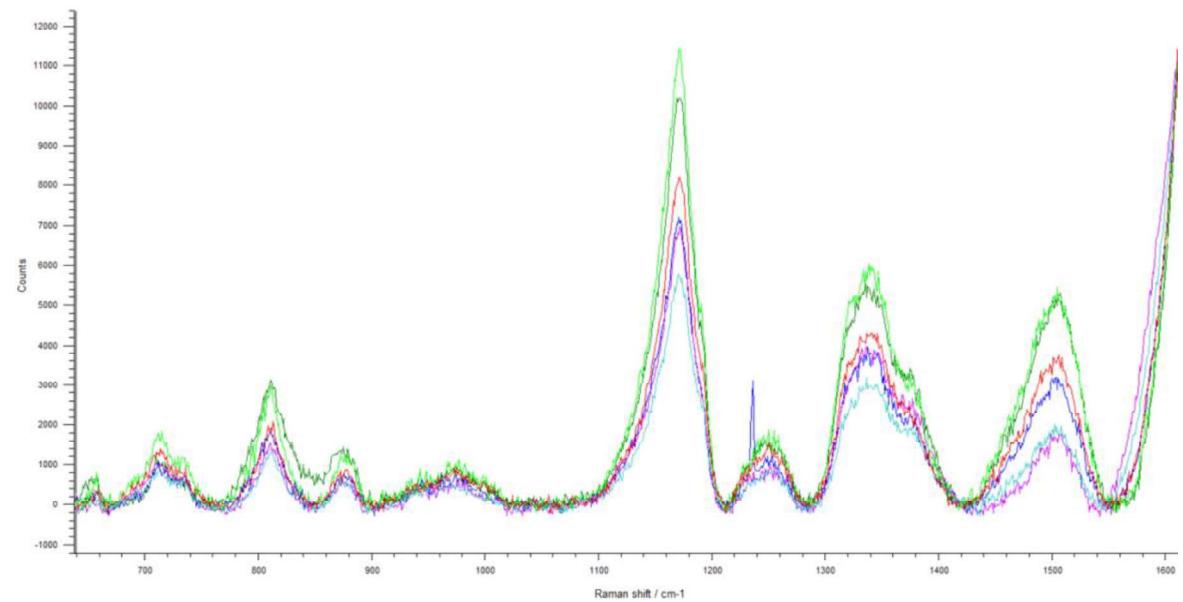
Obrázek B.1: Vnitřní vybavení Renishaw inVia Qontor Ramanova spektrometru



Obrázek B.2: Softwarové prostředí WiRe™

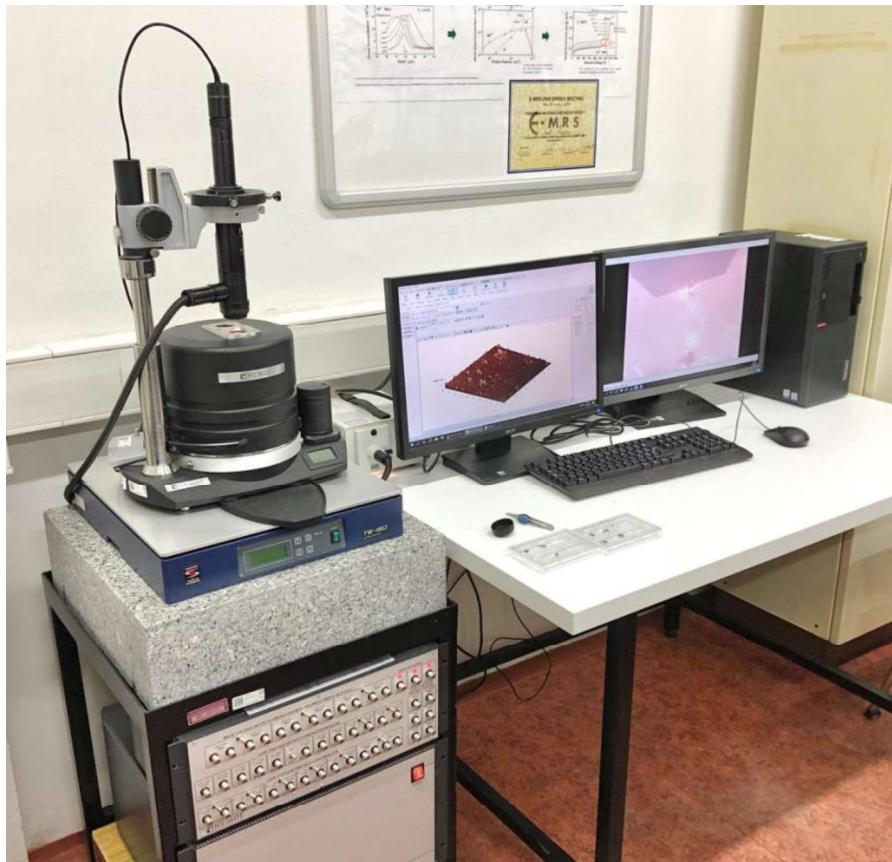


Obrázek B.3: Ramanovo spektrum bez fitování píků

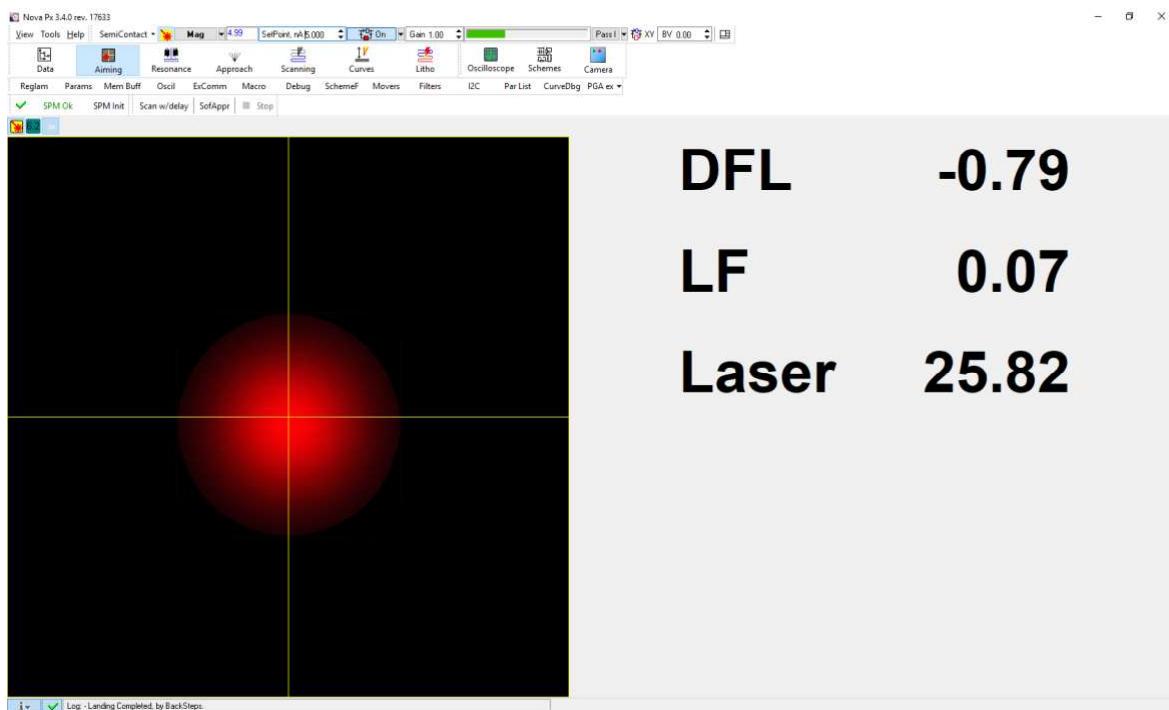


Obrázek B.4: Ramanovo spektrum s fitováním píků

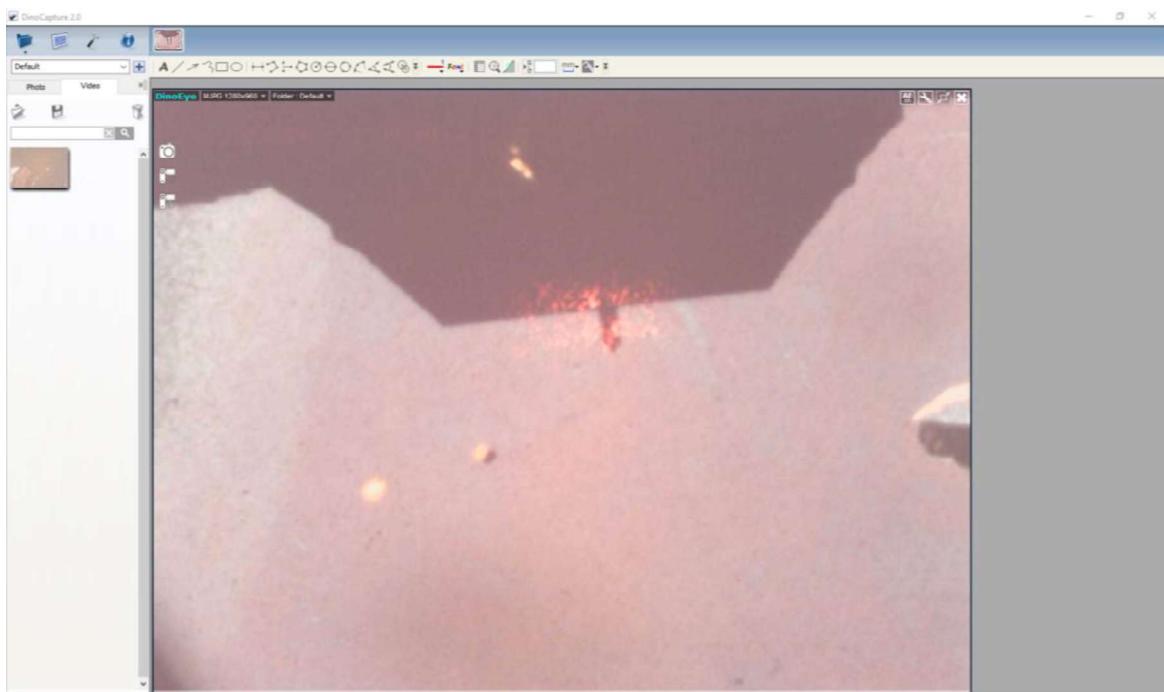
Příloha C. Měření na AFM mikroskopu



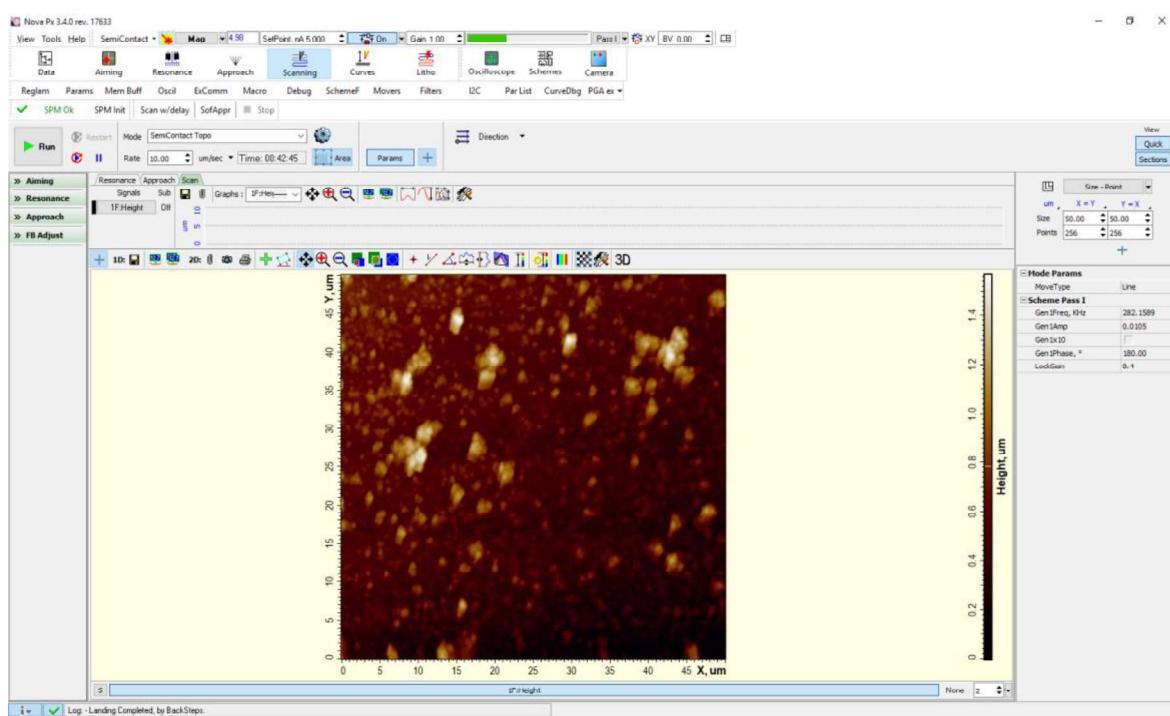
Obrázek C.1: Pracoviště pro měření s mikroskopem AFM Ntegra NT-MDT



Obrázek C.2: Nastavení paprsku laseru

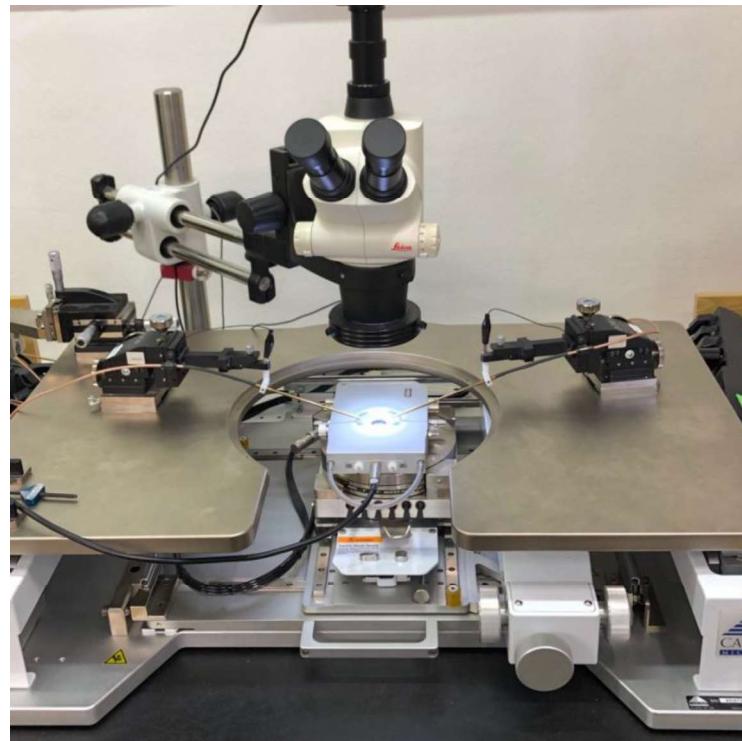


Obrázek C.3: Softwarové prostředí pro živé sledování pohybu hrotu

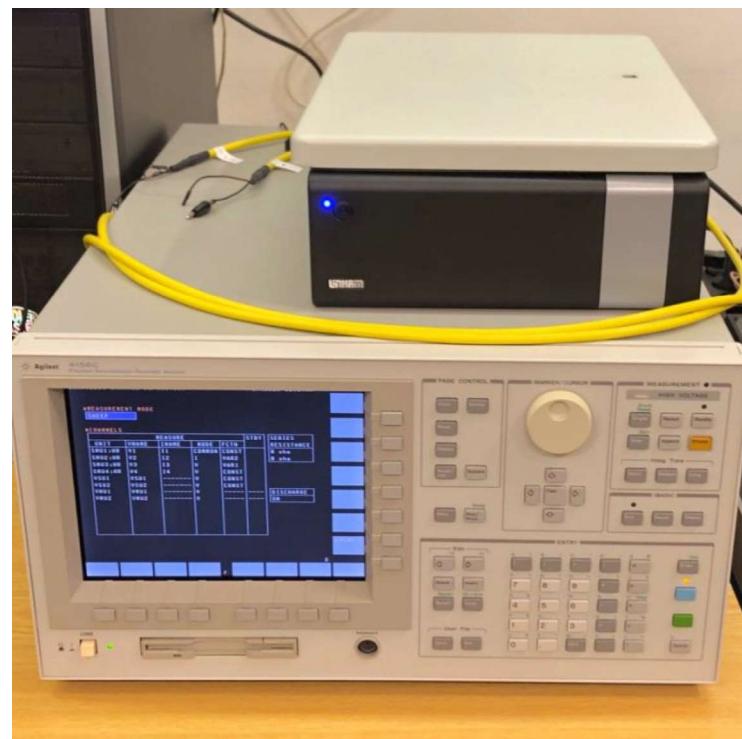


Obrázek C.4: Softwarové prostředí pro nastavení parametrů měření

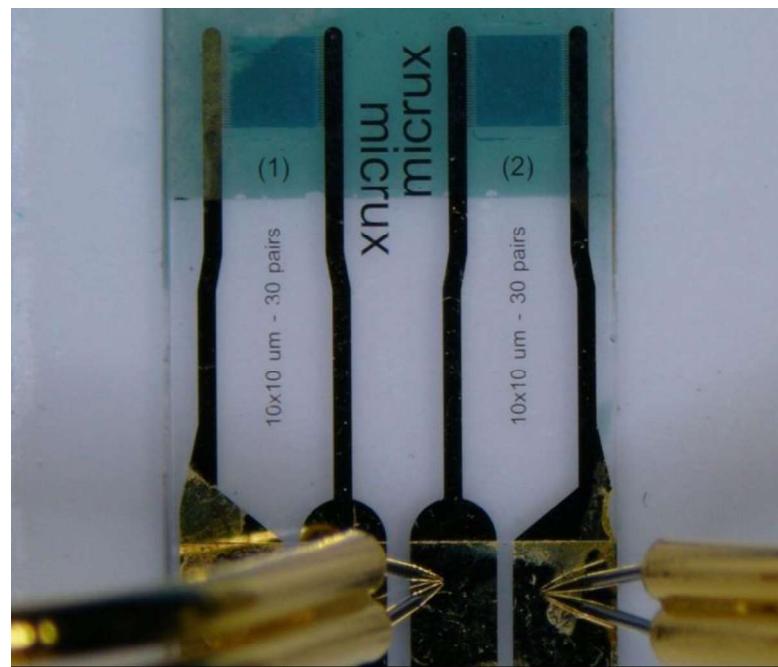
Příloha D. Měření elektrických vlastností



Obrázek D.1: Hrotová měřící stanice CASCADE MicroTech M150



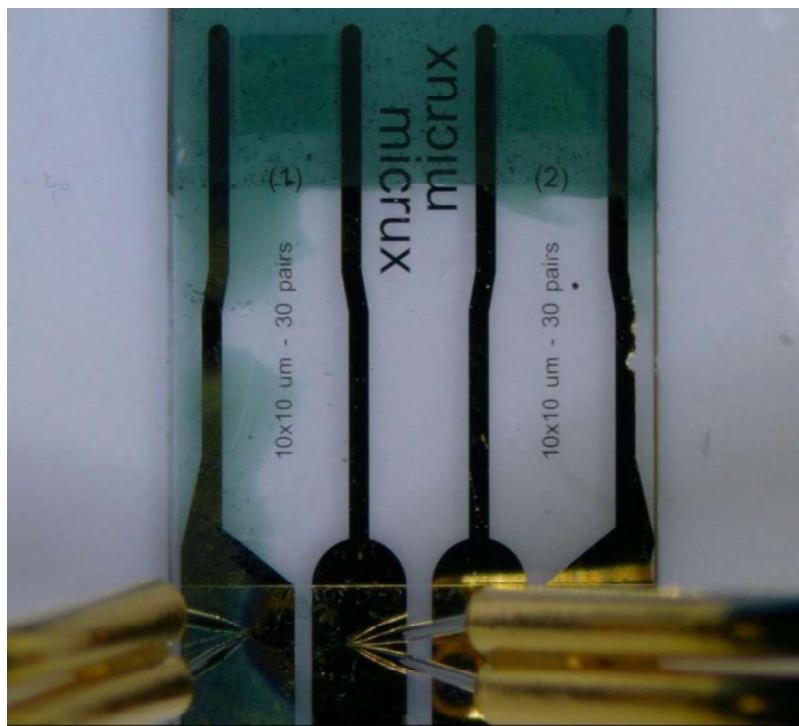
Obrázek D.2: Parametrický analyzátor Agilent 4156C



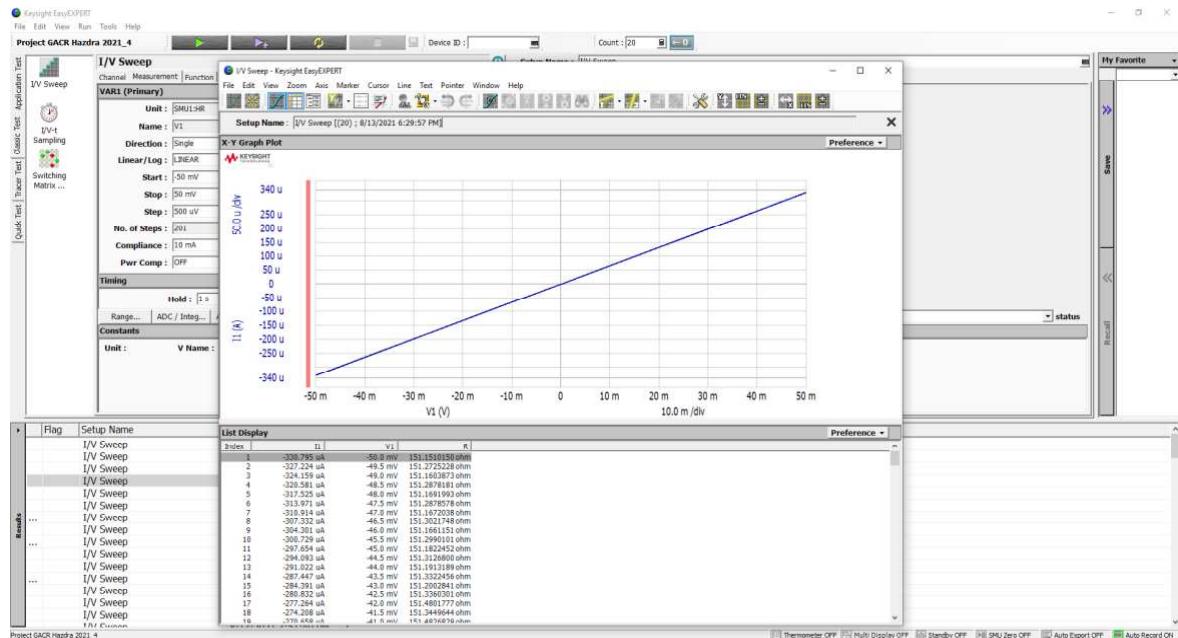
Obrázek D.3: Měření vodivosti filmu PANI-H₂SO₄ na elektrodách Micrux



Obrázek D.4: Měření vodivosti filmu PANI-HCl na elektrodách Micrux



Obrázek D.5: Měření vodivosti filmu PANI-CH₃COOH na elektrodách Micrux



Obrázek D.6: Softwarové okno aplikace Agilent EasyExpert pro měření V-A charakteristiky